

(19)



(11)

EP 2 335 556 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
22.06.2011 Patentblatt 2011/25

(51) Int Cl.:
A61B 1/00 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/1495 (2006.01) G01N 21/64 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **10194669.7**

(22) Anmeldetag: **13.12.2010**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

(71) Anmelder: **Karl Storz GmbH & Co. KG**
78532 Tuttlingen (DE)

(72) Erfinder:
• **Beck, Gerd**
78532, Tuttlingen (DE)
• **Ehrhardt, André**
78532, Tuttlingen (DE)
• **Glöggler, Bernhard**
78532, Tuttlingen (DE)

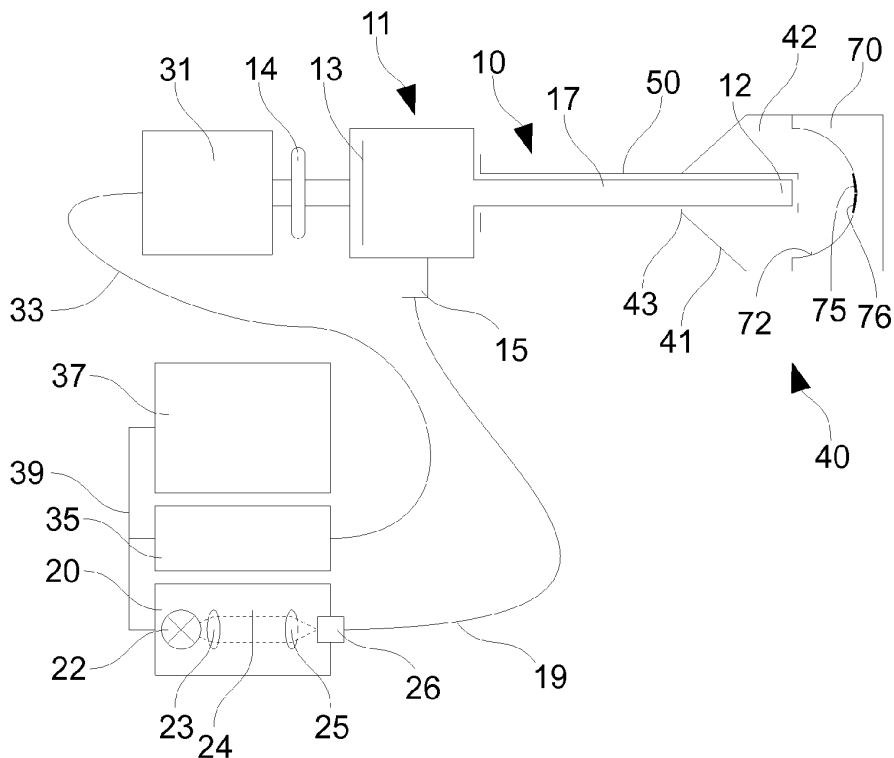
(30) Priorität: **16.12.2009 DE 102009058660**

(54) Prüfvorrichtung für ein optisches Untersuchungssystem

(57) Eine Prüfvorrichtung (40) für ein optisches Untersuchungssystem mit einer bildgebenden Einrichtung (10) und einer Lichtquelle (22) zur optischen Untersuchung eines Objekts in remittiertem Licht und/oder Fluoreszenzlicht umfasst ein Gehäuse (41) mit einem Hohlraum (42) und einer Öffnung (43) zum Einführen eines distalen Endes (12) der bildgebenden Einrichtung (10) in den Hohlraum (43), eine Referenzoberfläche (72) mit

vorbestimmten optischen Eigenschaften in dem Hohlraum (42), zumindest entweder zur Remission von auf die Referenzoberfläche (72) gerichtetem Beleuchtungslicht oder zur Emission von Fluoreszenzlicht, und eine Positionierungseinrichtung (50) zum Halten der bildgebenden Einrichtung (10) bei einer vorbestimmten Position des distalen Endes (12) der bildgebenden Einrichtung (10) relativ zur Referenzoberfläche (72).

Fig. 1



EP 2 335 556 A1

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Prüfvorrichtung für ein optisches Untersuchungssystem mit einer Lichtquelle und einer bildgebenden Einrichtung zur optischen Untersuchung eines Objekts innerhalb und außerhalb der Medizin. Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbesondere auf eine Prüfvorrichtung für ein Endoskopiesystem mit einer Lichtquelle und einem Endoskop.

[0002] Zur Endoskopie in medizinischen oder nicht-medizinischen Anwendungen - im zweiten Fall auch als Boroskopie bezeichnet - werden Endoskopiesysteme aus jeweils einem Endoskop und einer Lichtquelle verwendet. Die Lichtquelle kann in das Endoskop, insbesondere in dessen distales Ende, integriert sein oder als separate Einheit bereitstehen, die über ein Lichtleitkabel mit dem Endoskop optisch gekoppelt ist. Licht der Lichtquelle tritt am distalen Ende des Endoskops aus und beleuchtet dort ein zu betrachtendes Objekt. Vom Objekt remittiertes Licht wird von einer Optik am distalen Ende des Endoskops aufgefangen und auf einen lichtempfindlichen Bildsensor geleitet oder, beispielsweise mittels eines geordneten Bündels von Lichtwellenleitern oder einer Stablinsoptik, zum proximalen Ende des Endoskops übertragen. Im zweiten Fall ist das vom Objekt remittierte Licht am proximalen Ende des Endoskops über ein Okular beobachtbar oder wird mittels einer Kamera erfasst. Alternativ oder zusätzlich zu remittiertem Licht kann auch vom Objekt emittiertes Licht beobachtet werden, insbesondere Fluoreszenzlicht.

[0003] Die Qualität eines mittels eines Endoskopiesystems erfassten Bilds, insbesondere Helligkeit, Helligkeits- und Farbkontrast, Signal-Rausch-Abstand, Farbtreue und Auflösung bzw. Schärfe, hängt vom betrachteten Objekt, insbesondere seinen optischen Eigenschaften, und vor allem vom Endoskopiesystem ab. Relevante Faktoren sind beispielsweise die Funktionsfähigkeit der Lichtquelle, ihre Strahlungsleistung bzw. der von ihr erzeugte Lichtstrom, das Spektrum des erzeugten Lichts, ggf. die Übertragungseigenschaften eines verwendeten Lichtleitkabels und der Kopplung des Lichtleitkabels mit der Lichtquelle und dem Endoskop, die Funktionsfähigkeit der Lichtübertragung innerhalb des Endoskops, der Wirkungsgrad der Auskopplung des Lichts der Lichtquelle aus dem Endoskop, die Funktionsfähigkeit bzw. die optischen Eigenschaften des Beobachtungs-Strahlengangs im Endoskop, ggf. einschließlich eines geordneten Bündels von Lichtwellenleitern oder einer Stablinsoptik, die Funktionsfähigkeit des Okulars oder der Kamera. Häufige Fehlerquellen bilden u. a. die einem Alterungsprozess unterworfenen Lichtquelle, ggf. das Lichtleitkabel und seine Kopplung an die Lichtquelle und das Endoskop und die Kopplung einer Kamera an das Endoskop.

[0004] Insbesondere für medizinisch-diagnostische Zwecke wird Fluoreszenzlicht beobachtet. In der Photodynamischen Diagnostik (PDD) wird beispielsweise eine

durch verabreichtes 5-Aminolävulinsäure (ALA) induzierte Fluoreszenz von Protoporphyrin IX beobachtet. Die Anreicherung von ALA und damit auch die Intensität der Fluoreszenz sind vom Zustand des Gewebes abhängig. Bei der Autofluoreszenz-Diagnostik (AF-Diagnostik) wird die Fluoreszenz von körpereigenen Fluorophoren beobachtet, deren Konzentration ebenfalls vom Zustand des Gewebes abhängig ist. Auch außerhalb der Medizin werden fluoreszenzdiagnostische Verfahren verwendet.

[0005] Damit remittiertes Anregungslicht bzw. Beleuchtungslicht die Fluoreszenz nicht überstrahlt, werden im Beleuchtungs- bzw. Anregungs-Strahlengang zwischen Lichtquelle und Objekt ein Beleuchtungsfilter und im Beobachtungs-Strahlengang zwischen Objekt und Kamera bzw. Okular ein Beobachtungsfilter verwendet. Das Beleuchtungsfilter ist ein Kurzpassfilter, das im wesentlichen nur die zur Anregung der Fluoreszenz erforderlichen kurzen Wellenlängen transmittiert, längere Wellenlängen hingegen überwiegend oder fast ausschließlich reflektiert oder absorbiert. Eine sehr geringe, aber nicht verschwindende Transmission im Blockbereich ist bei manchen Anwendungen erwünscht, um auch ohne Fluoreszenz ein Bild zu erhalten, das eine geringe Helligkeit aufweist aber sichtbar ist. Das Beobachtungsfilter ist ein Langpassfilter, das nur Wellenlängen der Fluoreszenz transmittiert und vom Objekt remittiertes kurzwelliges Anregungslicht reflektiert oder absorbiert. Beleuchtungs- bzw. Anregungsfiler können in der Regel manuell oder maschinell ausgetauscht bzw. gewechselt werden. Beobachtungsfiler können austauschbar bzw. wechselbar sein, sind aber in vielen Fällen fest in das Endoskop eingebaut. Beispielsweise in der Urologie werden für die Beobachtung in Weißlicht, ALA- oder AF-Fluoreszenz verschiedene Endoskope verwendet, die zumindest im Beobachtungs-Strahlengang für ihre jeweilige Verwendung optimiert sind bzw. eine entsprechende Filtercharakteristik aufweisen. Zu den oben genannten Fehlerquellen bzw. Einflüssen auf die Funktionsfähigkeit des Endoskopiesystems tritt im Fall der Beobachtung von Fluoreszenz somit noch die Kombination des Beleuchtungsfilters bzw. des Spektrums der Lichtquelle einerseits und des Beobachtungsfilters andererseits.

[0006] Eine entsprechende Problemstellung existiert bei anderen optischen Untersuchungssystemen, die eine bildgebende Einrichtung und eine Lichtquelle zur optischen Untersuchung medizinischer und nicht-medizinischer Objekte in remittiertem Licht und/oder in Fluoreszenzlicht umfassen. Dazu zählen Exoskope, die beispielsweise zur Diagnostik und für mikrochirurgische Eingriffe an oder nahe Körperoberflächen verwendet werden.

[0007] In der DE 196 38 809 A1 ist eine Vorrichtung zur Prüfung und/oder Justierung eines PDD-oder PDT-Systems (PDT = Photodynamische Therapie) und/oder zur Schulung an einem derartigen System beschrieben. In einem Gehäuse ist ein Target angeordnet, dem gegenüber ein distales Ende eines Endoskops angeordnet werden kann. Die Krümmung des Targets kann der Ob-

jektfeldkrümmung einer bildgebenden Einheit des Endoskops entsprechen. Im Target sind ein Fotoelement und Lichtquellen vorgesehen. Das Fotoelement erfasst die Beleuchtungsstärke eines vom Endoskop ausgehenden Beleuchtungslichts. Eine Steuerung steuert die Lichtquellen als Funktion der vom Fotoelement erfassten Beleuchtungsstärke.

[0008] In der DE 198 55 853 A1 ist eine Vorrichtung zur Prüfung und/oder Justierung eines PDD-oder PDT-Systems und/oder zur Schulung an einem derartigen System beschrieben. Die Vorrichtung umfasst ein Lumineszenzphantom mit einem Fluoreszenzfarbstoff. Gegenüber dem Lumineszenzphantom kann ein Ende eines Endoskops angeordnet werden.

[0009] In der nachveröffentlichten DE 10 2009 043 696 sind eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Prüfen von Endoskopen beschrieben. Die Vorrichtung umfasst ein Filtermodul mit mehreren Durchbrüchen, in denen optische Filter angeordnet sind. Das Filtermodul wird aus einer Richtung durch die Lichtquelle über ein Lichtleitkabel beleuchtet. Aus einer entgegengesetzten Richtung wird das von dem Filtermodul transmittierte Licht mittels eines Endoskops beobachtet.

[0010] Abhängig von konkreten, in der Praxis sich ergebenden Aufgabenstellungen kann jede der bislang bekannten Vorrichtungen und Verfahren Vor- und Nachteile aufweisen. Beispielsweise ermöglicht unter einigen Bedingungen und für einige Anwendungen keine der beschriebenen Vorrichtungen und Verfahren eine zuverlässige und evtl. sogar quantitative Prüfung eines vollständigen Endoskopiesystems oder eines vollständigen anderen optischen Untersuchungssystems in genau dem Zustand, in dem es davor oder danach medizinisch oder nicht-medizinisch verwendet wurde oder wird.

[0011] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine verbesserte Prüfvorrichtung und ein verbessertes Verfahren zum Prüfen eines optischen Untersuchungssystems zu schaffen, die insbesondere eine absolute und genaue Prüfung der Funktionsfähigkeit oder einer anderen Eigenschaft des optischen Untersuchungssystems vereinfachen.

[0012] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst.

[0013] Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0014] Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung beruhen auf der Idee, bei einer Prüfvorrichtung für ein optisches Untersuchungssystem mit einer bildgebenden Einrichtung und einer Lichtquelle eine Positionierungseinrichtung zum Halten der bildgebenden Einrichtung bei einer vorbestimmten Position und insbesondere auch einer vorbestimmten Richtung des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung zu einer Referenzoberfläche der Prüfvorrichtung vorzusehen. Dazu weist die Positionierungsvorrichtung insbesondere einen mechanischen Anschlag auf, der so ausgebildet ist, dass das distale Ende einer in die Prüfvorrichtung eingesetzten bildgebenden Einrichtung an einer vorbestimmten Position,

insbesondere auch einem vorbestimmten Abstand zur Referenzoberfläche, liegt, wenn die bildgebende Einrichtung an dem Anschlag anliegt.

[0015] Die Positionierungseinrichtung ermöglicht auf einfache Weise eine reproduzierbare und genaue Positionierung des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung relativ zur Referenzoberfläche der Prüfvorrichtung. Die Prüfvorrichtung kann damit nicht nur für Schulungszwecke oder eine qualitative Messung oder Prüfung der Funktionsfähigkeit eines optischen Untersuchungssystems verwendet werden, sondern auch für eine quantitative Prüfung. Durch die präzise und reproduzierbare Positionierung des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung relativ zu der Referenzoberfläche der Prüfvorrichtung können beispielsweise aus der Helligkeit eines von der bildgebenden Einrichtung erzeugten Bilds der Referenzoberfläche quantitative Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit und andere Eigenschaften des optischen Untersuchungssystems gezogen werden. Wenn das von der bildgebenden Einrichtung erzeugte Bild der Referenzoberfläche zu dunkel ist, kann das nicht mehr an einer falschen Positionierung des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung relativ zur Referenzoberfläche liegen. Vielmehr muss ein Defekt an dem optischen Untersuchungssystem vorliegen, beispielsweise eine nicht mehr oder nur noch eingeschränkt funktionsfähige Lichtquelle, ein defektes Lichtleitkabel oder eine fehlerhafte Kopplung zwischen einem Lichtleitkabel und der Lichtquelle oder der bildgebenden Einrichtung.

[0016] Eine Prüfvorrichtung für ein optisches Untersuchungssystem mit einer bildgebenden Einrichtung und einer Lichtquelle zur optischen Untersuchung eines Objekts in remittiertem Licht und/oder in Fluoreszenzlicht umfasst ein Gehäuse mit einem Hohlraum und einer Öffnung zum Einführen eines distalen Endes der bildgebenden Einrichtung in den Hohlraum, eine Referenzoberfläche mit vorbestimmten optischen Eigenschaften in dem Hohlraum zumindest entweder zur Remission von auf die Referenzoberfläche fallendem Beleuchtungslicht oder zur Emission von Fluoreszenzlicht, und eine Positionierungseinrichtung zum Halten der bildgebenden Einrichtung bei einer vorbestimmten Position des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung relativ zur Referenzoberfläche.

[0017] Die Prüfvorrichtung ist insbesondere eine Prüfvorrichtung für ein Endoskopiesystem mit einem Endoskop und einer Lichtquelle. Die Lichtquelle kann in das Endoskop integriert sein oder als separate Einheit vorliegen. Im zweiten Fall kann die Lichtquelle, beispielsweise mittels eines Lichtleitkabels, mit der bildgebenden Einrichtung gekoppelt sein, wobei die bildgebende Einrichtung zur Übertragung von Beleuchtungslicht der Lichtquelle zum distalen Ende der bildgebenden Einrichtung ausgebildet ist. Alternativ kann das optische Untersuchungssystem ausgebildet sein, um Beleuchtungslicht der Lichtquelle über einen Beleuchtungsstrahlengang außerhalb der bildgebenden Einrichtung zu einem zu untersuchenden bzw. zu betrachtenden Objekt zu lei-

ten.

[0018] Die Referenzoberfläche kann eben oder gekrümmt, insbesondere konkav sein. Die vorbestimmten optischen Eigenschaften der Referenzoberfläche sind insbesondere zeitlich unveränderlich bzw. stabil. Zu den optischen Eigenschaften der Referenzoberfläche zählen insbesondere ihr Remissionsgrad als Funktion der Wellenlänge von Beleuchtungslicht und ggf. eine Fluoreszenz-Quantenausbeute als Funktion der anregenden Wellenlänge und der Wellenlänge des emittierten Fluoreszenzlichts. Hinsichtlich ihrer Remissionseigenschaften ist die Referenzoberfläche beispielsweise näherungsweise ein Lambert-Strahler mit einer näherungsweise ideal diffusen Remission.

[0019] Die Positionierungseinrichtung kann austauschbar sein, um die Prüfvorrichtungen mit unterschiedlichen bildgebenden Einrichtungen betreiben zu können. Ferner kann die Positionierungseinrichtung ausgebildet sein, um zumindest dann, wenn eine bildgebende Einrichtung in die Prüfvorrichtung eingesetzt ist, den Hohlraum des Gehäuses der Prüfvorrichtung gegen den Einfall von Umgebungslicht abzusichern. Die durch die Positionierungseinrichtung vorbestimmte Position des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung relativ zu der Referenzoberfläche der Prüfvorrichtung, insbesondere der Abstand zwischen beiden, kann so gewählt sein, dass die relative Position einer typischen Position des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung bei einer optischen Untersuchung eines Objekts entspricht. Die Prüfvorrichtung ermöglicht somit eine Prüfung eines optischen Untersuchungssystems unter realistischen Bedingungen.

[0020] Um eine Prüfung eines optischen Untersuchungssystems unter möglichst realistischen Bedingungen zu ermöglichen, kann die Prüfvorrichtung ferner ausgebildet sein, um Wasser oder ein anderes Fluid zu enthalten, dessen Brechungsindex größer als 1 ist. Dazu sind die Prüfvorrichtung und insbesondere das Gehäuse und die Positionierungseinrichtung so ausgebildet, dass das Fluid zumindest dann nicht oder nur langsam entweicht, wenn eine bildgebende Einrichtung in die Prüfvorrichtung eingesetzt ist. Das Gehäuse und die Positionierungseinrichtung umfassen dazu beispielsweise O-Ringe oder andere Dichtungen. Wenn die Prüfvorrichtung dazu ausgebildet ist, eine Flüssigkeit zu enthalten, kann die Öffnung zum Hohlraum im Gehäuse in einem oberen Bereich angeordnet sein, insbesondere am höchsten Punkt des Hohlraums. Dies ermöglicht beispielsweise eine Simulation der Bedingungen, die in der Urologie bei einer endoskopischen Untersuchung einer mit Harn gefüllten Harnblase vorliegen.

[0021] Die Positionierungseinrichtung kann ferner dazu ausgebildet sein, eine Rotation einer in die Prüfvorrichtung eingesetzten bildgebenden Einrichtung um ihre Längsachse zu unterbinden. Dazu umfasst die Positionierungseinrichtung insbesondere eine Einrichtung zum kraftschlüssigen oder formschlüssigen Unterbinden einer Rotation einer bildgebenden Einrichtung, beispiels-

weise eine Kugel-Rastvorrichtung. Diese Einrichtung kann gleichzeitig dazu ausgebildet sein, eine in die Prüfvorrichtung eingesetzte bildgebende Einrichtung, insbesondere ihr distales Ende, an der vorbestimmten Position zu halten. Das Unterbinden einer Rotation einer bildgebenden Einrichtung in der Prüfvorrichtung um ihre Längsachse kann insbesondere bei nicht-axialer Blickrichtung der bildgebenden Einrichtung vorteilhaft sein, um sicherzustellen, dass die bildgebende Einrichtung auf die Referenzoberfläche oder gegebenenfalls auf ein bestimmtes Merkmal, beispielsweise eine Marke, an der Referenzoberfläche gerichtet ist.

[0022] Eine Prüfvorrichtung, wie sie hier beschrieben ist, kann so ausgebildet sein, dass die Positionierungseinrichtung ohne Verwendung von Werkzeug von dem Gehäuse der Prüfvorrichtung getrennt und mit diesem wieder verbunden werden kann. Dazu ist insbesondere am Gehäuse der Prüfvorrichtung eine Kugel-Rasteinrichtung vorgesehen, die in eine Ausnehmung oder Hinterschneidung an der Positionierungseinrichtung eingreifen kann, um die Positionierungseinrichtung an dem Gehäuse der Prüfvorrichtung zu halten. Dies ermöglicht nicht nur eine unaufwendige und schnelle Zerlegung der Prüfvorrichtung zur Reinigung und Sterilisierung, sondern auch einen schnellen Austausch der Positionierungseinrichtung zur Anpassung der Prüfvorrichtung an unterschiedliche bildgebende Einrichtungen.

[0023] Eine Prüfvorrichtung, wie sie hier beschrieben ist, insbesondere eine Prüfvorrichtung bei der die Positionierungseinrichtung ohne Verwendung von Werkzeug von dem Gehäuse getrennt werden kann, kann am Gehäuse und an der Positionierungseinrichtung Einrichtungen zum formschlüssigen Unterbinden einer Rotation der Positionierungseinrichtung um ihre Längsachse relativ zu dem Gehäuse umfassen. Solche Einrichtungen umfassen beispielsweise einen Stift oder eine andere konvexe Einrichtung am Gehäuse, der oder die in eine Längsnut oder eine andere konkave Einrichtung an der Positionierungseinrichtung eingreift. Dies unterstützt eine definierte Ausrichtung des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung relativ zur Referenzoberfläche. Die definierte Ausrichtung des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung relativ zur Referenzoberfläche kann unter anderem vorteilhaft sein im Fall einer nicht-kugelförmigen Referenzoberfläche und im Fall von Marken oder anderen Merkmalen an der Referenzoberfläche, auf welche die bildgebende Einrichtung zu richten ist.

[0024] Eine Prüfvorrichtung, wie sie hier beschrieben ist, insbesondere eine Prüfvorrichtung, bei der die Positionierungseinrichtung ohne Verwendung von Werkzeug von dem Gehäuse getrennt und wieder mit ihm verbunden werden kann, kann eine Rasteinrichtung, insbesondere eine Kugel-Rasteinrichtung, umfassen, die dazu ausgebildet ist, die Positionierungseinrichtung lösbar an der Öffnung bzw. am Gehäuse der Prüfvorrichtung zu befestigen.

[0025] Die Positionierungseinrichtung einer Prüfvorrichtung, wie sie hier beschrieben ist, kann an ihrem vom

Hohlraum abgewandten Ende eine Halteeinrichtung, insbesondere eine Kugelraste, zum rastenden Halten des proximalen Endes einer in die Prüfvorrichtung eingesetzten bildgebenden Einrichtung umfassen. Diese Halteeinrichtung ist beispielsweise eine Kugel-Rasteinrichtung, die in eine Ausnehmung oder Hinterschneidung am proximalen Ende einer bildgebenden Einrichtung eingreifen kann. Einige bildgebende Einrichtungen, insbesondere Endoskope, weisen von Haus aus eine derartige Ausnehmung bzw. Hinterschneidung für andere Zwecke auf. Insbesondere bei einem Endoskop mit einem Schaft mit einer definierten oder standardisierten Länge kann eine Festlegung der Position des proximalen Endes der bildgebenden Einrichtung zwangsläufig eine vorbestimmte Position des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung zur Folge haben. Dabei muss die bildgebende Einrichtung an ihrem distalen Ende keine Merkmale aufweisen, die ein formschlüssiges Halten der bildgebenden Einrichtung ermöglichen, sondern kann beispielsweise eine einfache kreiszylindrische Form aufweisen.

[0026] Die Referenzoberfläche ist insbesondere so ausgebildet, dass für eine oder mehrere verschiedene Blickrichtungen einer in die Prüfvorrichtung eingesetzten bildgebenden Einrichtung die Tangentialfläche an die Referenzoberfläche im Schnittpunkt der Blickrichtung mit der Referenzoberfläche jeweils senkrecht zur Blickrichtung steht. Ferner kann die Referenzoberfläche so ausgebildet sein, dass für mehrere verschiedene Blickrichtungen der Abstand zwischen der vorbestimmten Position des distalen Endes der bildgebenden Einrichtung und dem jeweiligen Schnittpunkt der Blickrichtung mit der Referenzoberfläche gleich ist. Die Blickrichtung ist die Richtung vom distalen Ende der bildgebenden Einrichtung aus, in der ein Gegenstand liegt, der in der Mitte eines durch die bildgebenden Einrichtung erzeugten Bilds liegt.

[0027] Die Referenzoberfläche kann einen Ausschnitt aus einer Kugeloberfläche bilden, wobei die für das distale Ende der bildgebenden Einrichtung vorgesehene Position am Mittelpunkt der Kugeloberfläche liegt. Mit dem distalen Ende der bildgebenden Einrichtung ist in diesem Zusammenhang insbesondere der objektseitige Hauptpunkt bzw. der Schnittpunkt der optischen Achse mit der objektseitigen Hauptebene der bildgebenden Einrichtung gemeint. Bei einer kugelflächenförmigen Ausbildung der Referenzoberfläche kann hingenommen werden, dass eine in die Prüfvorrichtung eingesetzte bildgebende Einrichtung um ihre Längsachse frei rotierbar ist. Insbesondere muss in diesem Fall die Positionierungseinrichtung nicht dazu ausgebildet sein, eine Rotation der bildgebenden Einrichtung zu unterbinden.

[0028] Alternativ kann die Referenzoberfläche einen Ausschnitt aus einer Kreiszylinderfläche bilden, wobei die für das distale Ende der bildgebenden Einrichtung vorgesehene Position an der Symmetrieachse der Kreiszylinderfläche liegt. Die Krümmung bzw. der Radius der Referenzoberfläche kann an die Objektfeldkrümmung der bildgebenden Einrichtung angepasst sein, die wie-

derum typischerweise an die vorgesehene Anwendung des optischen Untersuchungssystems angepasst ist. Der Radius der Kugeloberfläche bzw. der Kreiszylinderfläche beträgt deshalb für viele Anwendungen höchstens 100 mm und liegt insbesondere im Bereich zwischen 10 mm und 50 mm oder auch im Bereich von 5 mm oder darunter, bis hin zur Kontaktendoskopie. Kugeloberflächen und Kreiszylinderflächen können mit vergleichsweise geringem Aufwand erzeugt werden und ermöglichen einen definierten Abstand der Referenzoberfläche vom distalen Ende der bildgebenden Einrichtung auch bei Verwendung der Prüfvorrichtung für bildgebende Einrichtungen mit unterschiedlichen Blickrichtungen.

[0029] Wenn die Referenzoberfläche einen Ausschnitt aus einer Kugeloberfläche bildet, kann die Referenzoberfläche so ausgebildet sein, dass zwei gegenüberliegende Orte am Rand der Referenzoberfläche auf einer Geraden liegen, die einen Winkel zwischen 40 und 80 Grad zur Längsachse einer von der Positionierungseinrichtung gehaltenen bildgebenden Einrichtung bildet. Insbesondere liegt der Winkel im Bereich von 50 Grad bis 70 Grad. Wenn die Referenzoberfläche einen Ausschnitt aus einer Kugeloberfläche bildet, insbesondere halbkugelförmig ist, kann der Rand der Referenzoberfläche in einer Ebene liegen, deren Normale einen Winkel im Bereich von 10 Grad bis 50 Grad zur Längsachse einer von der Positionierungseinrichtung gehaltenen bildgebenden Einrichtung bildet. Der Winkel zwischen der Normalen der Ebene und der Längsachse der Positionierungseinrichtung liegt insbesondere im Bereich von 20 Grad bis 40 Grad, beispielsweise bei 30 Grad. Wenn die Referenzoberfläche einen Ausschnitt aus einer Kreiszylinderfläche bildet, bildet eine Gerade durch zwei gegenüberliegende Orte am Rand der Referenzoberfläche oder eine Ebene, die zwei gegenüberliegende gerade Abschnitte des Rands der Referenzoberfläche enthält, einen Winkel zwischen 40 Grad und 80 Grad mit der Längsachse einer von der Positionierungseinrichtung gehaltenen bildgebenden Einrichtung. Der Winkel liegt insbesondere im Bereich von 50 Grad bis 70 Grad, beispielsweise bei 60 Grad.

[0030] Eine Prüfvorrichtung mit einer so ausgestalteten Referenzoberfläche ist zum Prüfen von optischen Untersuchungssystemen mit bildgebenden Einrichtungen mit unterschiedlichen Blickrichtungen geeignet. Die Prüfvorrichtung kann somit beispielsweise für die meisten Endoskope mit einer großen Vielzahl von verschiedenen Blickrichtungen verwendet werden, ohne dass die Referenzoberfläche ausgetauscht werden müsste.

[0031] Eine Prüfvorrichtung, wie sie hier beschrieben ist, ist insbesondere zumindest teilweise zerlegbar und vollständig sterilisierbar. Insbesondere sind auch die Referenzoberfläche und die Positionierungseinrichtung uneingeschränkt sterilisierbar. Eine bildgebende Einrichtung kann deshalb noch mittels der Prüfvorrichtung geprüft werden, unmittelbar bevor die bildgebende Einrichtung medizinisch verwendet wird und ohne sie nach der Prüfung nochmals sterilisieren zu müssen.

[0032] Die Referenzoberfläche einer Prüfvorrichtung, wie sie hier beschrieben ist, ist weiß oder weist einen für einen Weißabgleich ausreichend großen weißen Bereich auf. Dies bedeutet insbesondere, dass der Remissionsgrad der Referenzoberfläche oder ihres weißen Bereichs im für das menschliche Auge sichtbaren Wellenlängebereich - höchstens von kleinen Wellenlängenbereichen abgesehen - hoch ist, beispielsweise mindestens 80 % beträgt. Insbesondere ist die Referenzoberfläche eine Oberfläche eines Körpers aus gefülltem Polytetrafluorethylen oder Silikon. Die Referenzoberfläche ist damit auch zur Durchführung eines Weißabgleichs geeignet. Polytetrafluorethylen wird u. a. unter der Bezeichnung Teflon von DuPont vertrieben, weist stabile bzw. zeitlich unveränderliche optische Eigenschaften auf und kann ohne Weiteres autoklaviert werden.

[0033] Alternativ ist die Referenzoberfläche grau oder farbig und/oder weist einen oder mehrere graue oder farbige Bereiche auf. Der Remissionsgrad und/oder die Farbe und/oder Fluoreszenzeigenschaften der Referenzoberfläche oder von Teilen derselben können an typische oder durchschnittliche Remissionsgrade oder Farbtöne bzw. Farbwerte oder Fluoreszenzeigenschaften relevanter zu untersuchender Objekte angepasst sein. Insbesondere können die optischen Eigenschaften der Referenzoberfläche oder eines oder mehrerer Bereiche derselben den mittleren optischen Eigenschaften von biologischem Gewebe nachgebildet sein. Ferner können die optischen Eigenschaften der Referenzoberfläche strukturiert sein, um beispielsweise Blutgefäße oder andere Strukturen von biologischem Gewebe nachzubilden.

[0034] Bei einem Verfahren zum Prüfen eines optischen Untersuchungssystems mit einer bildgebenden Einrichtung und einer Lichtquelle zur optischen Untersuchung eines Objekts in remittiertem Licht und/oder Fluoreszenzlicht wird das distale Ende der bildgebenden Einrichtung durch eine Öffnung in einen Hohlraum in einem Gehäuse einer Prüfvorrichtung eingeführt. Das distale Ende der bildgebenden Einrichtung wird beim Einführen oder danach an einer vorbestimmten Position relativ zu einer Referenzoberfläche mit vorbestimmten optischen Eigenschaften in dem Hohlraum angeordnet. Die Referenzoberfläche wird mittels der bildgebenden Einrichtung mit Beleuchtungslicht mit einem vorbestimmten Beleuchtungsspektrum beleuchtet. Das durch die Referenzoberfläche remittierte Licht wird mittels der bildgebenden Einrichtung erfasst. Die Funktionsfähigkeit oder eine andere Eigenschaft des optischen Untersuchungssystems wird anhand des erfassten remittierten Lichts bestimmt.

[0035] Das Prüfverfahren wird insbesondere mit einer der hier beschriebenen Prüfvorrichtungen durchgeführt.

[0036] Kurzbeschreibung der Figuren

[0037] Nachfolgend werden Ausführungsformen anhand der beigefügten Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines opti-

schen Untersuchungssystems;

- Figur 2 eine schematische Darstellung eines Endoskops mit einer Prüfvorrichtung;
- Figur 3 eine schematische Darstellung einer Prüfvorrichtung;
- Figur 4 eine schematische Darstellung einer Prüfvorrichtung mit einem Endoskop;
- Figur 5 eine schematische Darstellung einer Prüfvorrichtung;
- Figur 6 eine weitere schematische Darstellung der Prüfvorrichtung aus Figur 5;
- Figur 7 eine schematische Darstellung mehrerer Spektren;
- Figur 8 eine schematische Darstellung von Produkten von Transmissionspektren;
- Figur 9 eine schematische Darstellung von Weißabgleich-Parametern;
- Figur 10 eine schematische Darstellung weiterer Weißabgleich-Parameter;
- Figur 11 ein schematisches Flussdiagramm.

[0038] Beschreibung der Ausführungsformen

[0039] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines optischen Untersuchungssystems. Das optische Untersuchungssystem ist in diesem Beispiel ein Endoskopiesystem, das beispielsweise bei medizinisch-diagnostischen Verfahren in der Urologie und in anderen Fachgebieten einsetzbar ist. Das Endoskopiesystem umfasst ein Endoskop 10 mit einem proximalen Ende 11 und einem distalen Ende 12. Das Endoskop 10 umfasst einen Beleuchtungs- bzw. Anregungs-Strahlengang und einen Beobachtungs-Strahlengang, die in Figur 1 nicht im Detail dargestellt sind. Der Beleuchtungs-Strahlengang umfasst insbesondere einen oder mehrere Lichtwellenleiter zum Übertragen von Beleuchtungs- bzw. Anregungslicht vom proximalen Ende 11 zum distalen Ende 12 und einen Lichtaustritt am distalen Ende 12, durch den Beleuchtungslicht aus dem distalen Ende 12 des Endoskops 10 austreten kann, um ein zu betrachtendes Objekt zu beleuchten. Der Beobachtungs-Strahlengang umfasst einen Lichteintritt am distalen Ende 12 des Endoskops 10, eine Optik zum Übertragen von Beobachtungslicht, das von einem betrachteten Objekt ausgeht, vom distalen Ende 12 zum proximalen Ende 11, ein Beobachtungsfilter 13 und ein Okular 14. Zum Übertragen des Beobachtungslichts vom distalen Ende 12 zum proximalen Ende 11 des Endoskops 10 ist beispielsweise eine Stablinsenoptik oder ein geordnetes Bündel von Lichtwellenleitern

in einem Schaft 17 des Endoskops 10 vorgesehen. Das Endoskop 10 weist ferner am proximalen Ende 11 eine Kupplung 15 zum mechanischen und optischen Koppeln eines Lichtleitkabels 19 mit dem beschriebenen Beleuchtungs-Strahlengang im Endoskop 10 auf.

[0040] Das Endoskop 10 ist über das Lichtleitkabel 19 mit einer Lichtquellenvorrichtung 20 gekoppelt. Die Lichtquellenvorrichtung 20 umfasst eine Lichtquelle 22, beispielsweise eine Halogen-Glühlampe, eine Hochdruck-Gasentladungslampe, eine Leuchtdiode oder einen Laser. Ferner umfasst die Lichtquellenvorrichtung 20 eine erste Sammellinse 23, ein Beleuchtungsfilter 24 und eine zweite Sammellinse 25. Die Lichtquelle 22 ist über die erste Sammellinse 23, das Beleuchtungsfilter 24, die zweite Sammellinse 25 und eine Kupplung 26 mit dem Lichtleitkabel 19 gekoppelt.

[0041] Eine Kamera 31 ist über das Okular 14 mit dem Endoskop 10 und dessen Beobachtungs-Strahlengang mechanisch bzw. optisch gekoppelt. Die Kamera 31 umfasst einen lichtempfindlichen Bildsensor, beispielsweise einen CCD- oder CMOS-Sensor, zum Wandeln von auf den Bildsensor fallendem Licht in analoge oder digitale elektrische Signale. Die Kamera 31 ist über ein Signalkabel 33 zur Übertragung analoger oder digitaler elektrischer oder optischer Signale mit einer Kamerasteuerung 35 gekoppelt, die auch als CCU = camera control unit bezeichnet wird.

[0042] Die Lichtquellenvorrichtung 20, die Kamerasteuerung 35 und ein Bildschirm 37 sind über einen Kommunikationsbus 39 oder mehrere separate Signalleitungen miteinander gekoppelt. Über den Kommunikationsbus 39 können weitere, in Figur 1 nicht dargestellte Vorrichtungen innerhalb oder außerhalb des Behandlungsraums, in dem das Endoskopiesystem angeordnet ist, mit der Lichtquellenvorrichtung 20, der Kamerasteuerung 35 und dem Bildschirm 37 gekoppelt sein, beispielsweise eine Datenbank, eine Tastatur, eine Computermaus und andere Benutzerschnittstellen.

[0043] In Figur 1 ist ferner eine Prüfvorrichtung 40 mit einem lichtdichten Gehäuse 41, einem Hohlraum 42 in dem lichtdichten Gehäuse 41 und einer Öffnung 43 zum Hohlraum 42 dargestellt. Das distale Ende 12 des Endoskops 10 ist durch die Öffnung 43 in den Hohlraum 42 der Prüfvorrichtung 40 eingeführt. Eine in der Öffnung 43 angeordnete Positionierungseinrichtung 50 hält form- und/oder kraftschlüssig den Schaft 17 des Endoskops 10 so, dass das distale Ende 12 des Endoskops 10 an einer vorbestimmten Position und in einer vorbestimmten Richtung im Hohlraum 42 angeordnet ist. Ferner verhindert die Positionierungseinrichtung 50, zumindest wenn der Schaft 17 des Endoskops 10 in der Positionierungseinrichtung 50 angeordnet ist, weitgehend das Eindringen von Licht aus der Umgebung durch die Öffnung 43 in den Hohlraum 42 im Gehäuse 41.

[0044] Im Hohlraum 42 der Prüfvorrichtung 40 ist ferner ein Referenzkörper 70 mit einer Referenzoberfläche 72 angeordnet. Die Referenzoberfläche 72 weist vorbestimmte optische Eigenschaften und die räumliche Ge-

stalt eines Ausschnitts aus einer Kugeloberfläche oder aus einem Kreiszyliindermantel auf. Die für das distale Ende 12 des Endoskops 10 vorgesehene Position liegt insbesondere am Mittelpunkt dieser Kugeloberfläche bzw. an der Symmetrieachse des Kreiszyliindermantels. Insbesondere liegt der objektseitige Hauptpunkt bzw. der Schnittpunkt der optischen Achse mit der objektseitigen Hauptebene der bildgebenden Einrichtung 10 am Mittelpunkt der Kugeloberfläche bzw. an der Symmetrieachse des Kreiszyliindermantels.

[0045] Die Referenzoberfläche 72 weist zeitlich unveränderliche bzw. stabile vorbestimmte optische Eigenschaften auf. Die Referenzoberfläche 72 kann weiß sein bzw. einen Remissionsgrad aufweisen, der im für das menschliche Auge sichtbaren Spektralbereich im Wesentlichen wellenlängenunabhängig ist. Die Referenzoberfläche 72 kann alternativ farbig sein bzw. einen im für das menschliche Auge sichtbaren Spektralbereich wellenlängenabhängigen Remissionsgrad aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann die Referenzoberfläche 72 fluoreszierend sein. Dabei liegen die zur Anregung der Fluoreszenz erforderlichen Wellenlängen beispielsweise im ultravioletten oder, für medizinische Anwendungen bevorzugt, im blauen Spektralbereich und das emittierte Fluoreszenzlicht im grünen, roten oder infraroten Spektralbereich. Die optischen Eigenschaften können über die gesamte Referenzoberfläche 72 homogen bzw. ortsunabhängig sein.

[0046] Alternativ weist die Referenzoberfläche mehrere Bereiche mit verschiedenen optischen Eigenschaften auf. Bei dem in Figur 1 dargestellten Beispiel ist die Referenzoberfläche 72 überwiegend weiß mit einem Indikatorbereich 75 und einem Referenzbereich 76, die jeweils vom Rest der Referenzoberfläche 72 verschiedene optische Eigenschaften aufweisen. Der Indikatorbereich 75 und der Referenzbereich 76 können mit scharfen Rändern oder aufgrund ihrer Anordnung oder Gestalt eine Fokussierung oder eine Einstellung der Brennweite bzw. der Größe des Sichtfelds der bildgebenden Einrichtung vereinfachen oder ermöglichen. Darüber hinaus können die optischen Eigenschaften des Indikatorbereichs 75 und des Referenzbereichs 76 eine Bestimmung des Transmissionsspektrums des Beleuchtungsfilters 24 und des Transmissionsspektrums des Beobachtungsfilters 13 vereinfachen.

[0047] Der Referenzkörper 70 besteht, von dem Indikatorbereich und dem Referenzbereich 75 an der Referenzoberfläche 72 abgesehen, insbesondere aus Polytetrafluorethylen PTFE, das beispielsweise unter dem Markennamen Teflon von DuPont vertrieben wird, oder aus Silikon. Sowohl PTFE als auch Silikon kann mit weißen oder farbigen Pigmenten oder Farbstoffen gefüllt sein.

[0048] Figur 2 zeigt eine schematische axonometrische Darstellung eines Endoskops 10 und einer Prüfvorrichtung 40, die dem Endoskop und der Prüfvorrichtung ähnlich sind, die oben anhand der Figur 1 dargestellt wurden. Im Unterschied zur Figur 1 sind keine separate Licht-

quelle, Kamera oder andere Vorrichtungen gezeigt. Die Positionierungseinrichtung 50 erstreckt sich bei dem in Figur 2 gezeigten Beispiel bis zum proximalen Ende 11 des Endoskops 10 und nimmt den gesamten Schaft des Endoskops 10 auf. Die exakte Positionierung des distalen Endes des Endoskops 10 in der Prüfvorrichtung 40 wird bei diesem Beispiel durch Formschluss zwischen der Positionierungseinrichtung 50 und dem distalen Ende 11 des Endoskops 10 erreicht, insbesondere mittels eines mechanischen Anschlags und/oder einer Rastverbindung.

[0049] Figur 3 zeigt eine schematische Ansicht der in Figur 2 gezeigten Prüfvorrichtung 40 aus der Richtung, aus der ein Endoskop 10 in die Prüfvorrichtung 40 eingeführt werden kann. Diese Richtung ist parallel zur Längsachse des Schafts 17 des Endoskops 10. Erkennbar ist die kreisförmige Kontur bzw. abschnittsweise kreiszylindrische äußere Form des Gehäuses 41. Um einen sicheren Stand der Prüfvorrichtung 40 zu ermöglichen, ist in das Gehäuse 41 integriert oder mit diesem dauerhaft mechanisch verbunden ein Standfuß 44. Anordnung und Funktion eines Anschlags 56 für ein Endoskop 10 und einer Kugel-Rasteinrichtung 57 sind in Figur 4 besser erkennbar.

[0050] Figur 4 zeigt eine weitere schematische Darstellung der in Figur 2 axonometrisch dargestellten Konfiguration aus der Prüfvorrichtung 40 und dem Endoskop 10. Figur 4 zeigt eine Ansicht aus einer Richtung senkrecht zur Längsachse des Schafts des Endoskops 10. Die Prüfvorrichtung 40 ist in einem Längsschnitt dargestellt, wobei die Schnittebene die Längsachse des Schafts des Endoskops 10 enthält.

[0051] Deutlich erkennbar in Figur 4 sind das Gehäuse 41, der Hohlraum 42 im Gehäuse 41, die Öffnung 43 zum Hohlraum 42, der Standfuß 44, ein Stift 45, eine Kugel-Rasteinrichtung 46 am äußeren Ende der Öffnung 43, eine Nut 48 und ein Schraubverschluss 49 an der von der Öffnung 43 abgewandten Seite des Gehäuses 41. Ferner ist der Referenzkörper 70 mit der Referenzoberfläche 72 und einem Stift 74 erkennbar. Der Schraubverschluss 49 schließt den Hohlraum 42 ab. Wenn der Schraubverschluss 49 geöffnet ist, kann der Referenzkörper 70 aus dem Hohlraum 42 entnommen werden. Der Hohlraum 42 und der Referenzkörper 70 sind dann mit all ihren Oberflächen in idealer Weise für eine Reinigung und Sterilisierung zugänglich. Beim Einsetzen des Referenzkörpers 70 in den Hohlraum 42 greift der Stift 74 in die Nut 48 ein, so dass der Referenzkörper 70 eine vorbestimmte Lage einnimmt und nicht im Hohlraum 42 rotieren kann.

[0052] In Figur 4 ist ferner erkennbar, dass ein Ende 52 der Positionierungseinrichtung 50 durch die Öffnung 43 bis in den Hohlraum 42 der Prüfvorrichtung 40 reicht. Die Positionierungseinrichtung 50 ist im Wesentlichen genauso lang wie der Schaft 17 des Endoskops 10. Die Positionierungseinrichtung 50 führt und hält somit den Schaft 17 des Endoskops über seine gesamte Länge. In der vorgesehenen Position des Endoskops 10 liegt ein

Abschnitt der äußeren Oberfläche des Endoskops 10 nahe des proximalen Endes 11 an einem Anschlag 56 an der Positionierungseinrichtung 50 an. Gleichzeitig greift eine in Figur 4 nicht sichtbare federbelastete Kugel der Kugel-Rasteinrichtung 57 in eine Ausnehmung am Endoskop 10 nahe dessen proximalen Ende 11 ein. Damit ist die Position des Endoskops 10 relativ zur Positionierungseinrichtung 50 festgelegt. Abhängig von der Form der Ausnehmung im Endoskop 10, in die die Kugel-Rasteinrichtung 57 am vom Hohlraum 42 der Prüfvorrichtung 40 abgewandten Ende 51 der Positionierungseinrichtung 50 eingreift, kann diese rastende Verbindung gleichzeitig eine Rotation des Endoskops um die Längsachse des Schafts 17 unterbinden.

[0053] Das dem Hohlraum 42 der Prüfvorrichtung 40 zugewandte Ende 52 der Positionierungseinrichtung 50 ist im Wesentlichen kreiszylinderförmig und weist gegenüber der entsprechend geformten Öffnung 43 im Gehäuse 41 der Prüfvorrichtung 40 ein geringes Spiel auf. Eine Längsachse 58 der Positionierungseinrichtung 50 ist, wenn ein Endoskop 10 in die Positionierungseinrichtung 50 eingesetzt ist, parallel zu oder identisch mit einer Längsachse des Endoskops 10. Ein Kragen 54 an der Positionierungseinrichtung 50 liegt bei der vorgesehenen Position der Positionierungseinrichtung 50 an einer dafür vorgesehenen Fläche am Gehäuse 41 der Prüfvorrichtung 40 an und wird dort durch eine Kugel-Rasteinrichtung 46 gehalten. Dabei greift der in das Gehäuse 41 eingesetzte Stift 45 in einen Schlitz bzw. eine Nut 53 in der Positionierungseinrichtung 50 ein.

[0054] Somit stellen u. a. der Stift 74 am Referenzkörper 70 und die Nut 48 im Gehäuse 41, der Stift 45 am Gehäuse 41 und die Nut 53 in der Positionierungseinrichtung 50, der Kragen 54 an der Positionierungseinrichtung 50 und die Kugel-Rasteinrichtung 46 am Gehäuse 41 sowie der Anschlag 56 und die Kugel-Rasteinrichtung 57 in Zusammenarbeit mit einer in Figur 4 nicht dargestellten Ausnehmung im Endoskop 10 sicher, dass das distale Ende 12 des Endoskops 10 in einer vorbestimmten Position und Richtung relativ zu der Referenzoberfläche 72 in der Prüfvorrichtung 40 angeordnet ist.

[0055] Die Figuren 5 und 6 zeigen schematische Darstellungen einer weiteren Prüfvorrichtung 40 in zwei verschiedenen Schnitten. Die in Figur 5 dargestellte Schnittebene entspricht der Schnittebene in Figur 4 rechts. Die in Figur 6 dargestellte Schnittebene A-A ist in Figur 5 eingezeichnet und steht senkrecht zur Schnittebene der Figur 5.

[0056] Die in den Figuren 5 und 6 dargestellte Prüfvorrichtung 40 unterscheidet sich von der oben dargestellten Prüfvorrichtung dadurch, dass eine andere Positionierungseinrichtung 60 in die Öffnung 43 im Gehäuse 41 eingesetzt ist. Das Gehäuse 41, der Hohlraum 42, die Öffnung 43, der Standfuß 44, der Stift 45, die Kugel-Rasteinrichtung 46, die Nut 48, der Schraubverschluss 49 und der Referenzkörper 70 entsprechen denen der oben anhand der Figuren 2 bis 4 dargestellten Prüfvorrichtung.

[0057] Die in den Figur 5 und 6 gezeigte Positionierungseinrichtung 60 ist wesentlich kürzer als die oben anhand der Figuren 2 und 4 dargestellte Positionierungseinrichtung 50. Das vom Hohlraum 42 im Gehäuse 41 abgewandte Ende 61 der Positionierungseinrichtung 60 ragt aus der Öffnung 43 nur wenig hervor. An dem in den Hohlraum 42 ragenden Ende 62 der im Wesentlichen rohrförmigen Positionierungseinrichtung 60 ist ein mechanischer Anschlag 66 in Form eines das Lumen der Positionierungseinrichtung 60 reduzierenden Kragens angeordnet. Die Positionierungseinrichtung 60 wird ähnlich wie die oben dargestellte Positionierungseinrichtung 50 durch Wechselwirkung eines Kragens 64 mit der Kugel-Rasteinrichtung 46 am Gehäuse 41 der Prüfeinrichtung 40 gehalten. Der Stift 45 am Gehäuse 41 greift in eine Nut 63 in der Positionierungseinrichtung 60 ein. Eine Längsachse 68 der Positionierungseinrichtung 60 ist, wenn ein Endoskop 10 in die Positionierungseinrichtung 60 eingesetzt ist, parallel zu oder identisch mit einer Längsachse des Endoskops 10.

[0058] Die in den Figuren 5 und 6 gezeigte Positionierungseinrichtung 60 ist für die Positionierung eines distalen Endes eines flexiblen Endoskops gegenüber der Referenzoberfläche 72 ausgebildet. In der Zusammenschau der Figuren 4 bis 6 ist erkennbar, dass die Positionierungseinrichtungen 50, 60 an der Prüfvorrichtung 40 gegeneinander ausgetauscht werden können. Dazu ist kein Werkzeug erforderlich, die Positionierungseinrichtungen 50, 60 müssen lediglich gegen die Rastkraft der Kugel-Rasteinrichtung 46 in das Gehäuse 41 der Prüfvorrichtung 40 geschoben oder aus diesem gezogen werden. Neben Positionierungseinrichtungen für starre Endoskope mit einer bestimmten Schaftlänge und einem bestimmten Schaftdurchmesser und für flexible Endoskope mit einem bestimmten Schaftdurchmesser können weitere Positionierungseinrichtungen für andere Schaftdurchmesser oder andere Schaftlängen in die Öffnung 43 des Gehäuses 41 eingesetzt werden.

[0059] Ein weiterer Aspekt der einfachen Entnehmbarkeit und Einsetzbarkeit der Positionierungseinrichtungen 50, 60 ist, dass die Prüfvorrichtung 40 einfach zerlegt und alle Bestandteile einschließlich der Positionierungseinrichtung 50, 60 leicht gereinigt und - beispielsweise durch Autoklavieren - sterilisiert werden können. Dazu trägt auch bei, dass nach Abnehmen des Schraubverschlusses 49 der Referenzkörper 70 aus dem Hohlraum 42 entnommen werden kann. Zum Zerlegen und zum Zusammensetzen der Prüfvorrichtung 40 ist kein Werkzeug erforderlich.

[0060] Ein besonderer Aspekt der in den Figuren 4 bis 6 gezeigten Prüfvorrichtung 40 ist, dass die Referenzoberfläche 72 einen Ausschnitt aus einer Kugeloberfläche bildet. Die Positionierungseinrichtungen 50, 60 sind so ausgebildet, dass das distale Ende 12 eines in die Positionierungseinrichtung 50; 60 eingesetzten Endoskops 10 am Mittelpunkt der Kugeloberfläche angeordnet ist und damit von allen Punkten der Referenzoberfläche 72 den gleichen Abstand hat. Einige Endoskope

weisen ein gekrümmtes Objektfeld auf, d.h. die Menge der Orte, die gleichzeitig scharf (beispielsweise auf einen Bildsensor einer Kamera 31) abgebildet werden, bildet eine gekrümmte Fläche. Die Krümmung dieser Fläche ist insbesondere an die typische Krümmung einer Oberfläche eines Objekts, für deren Betrachtung das Endoskop vorgesehen ist, angepasst. Die Krümmung der Referenzoberfläche 72 und ihr Radius bzw. Abstand vom distalen Ende 12 des Endoskops 10 können an die Objektfeldkrümmung des Endoskops 10 angepasst sein, für das die Prüfvorrichtung 40 vorgesehen ist. Dies vereinfacht die Fokussierung des in die Prüfvorrichtung 40 eingesetzten Endoskops.

[0061] Ferner ist durch die kugelflächenförmige Gestalt der Referenzoberfläche 72 und die vorgesehene Position des distalen Endes 12 des Endoskops am Mittelpunkt der Kugeloberfläche der Abstand des Punkts auf der Referenzoberfläche 72, der in der Mitte des vom Endoskop 10 erzeugten Bilds liegt, vom distalen Ende 12 des Endoskops 10 unabhängig von der Blickrichtung des Endoskops. Die Prüfvorrichtung 40 kann somit für Endoskope mit unterschiedlichen Blickrichtungen verwendet werden.

[0062] In den Figuren 4 bis 6 ist ferner erkennbar, dass der Rand (in den Figur 4 und 5 insbesondere die in der Projektion auf die dargestellte Schnittebene gerade Linie zwischen den Punkten 77, 78) der Referenzoberfläche 72 nicht in einer Ebene senkrecht zur Längsachse 58, 68 der Positionierungseinrichtung 50; 60 liegt. Stattdessen liegt der Rand der Referenzoberfläche 72 in einer Ebene, deren Normale einen Winkel von ca. 30 Grad zur Längsachse 58, 68 der Positionierungseinrichtung 50; 60 bildet. Dies vergrößert das Spektrum der möglichen Blickrichtungen von Endoskopen, für die die Prüfvorrichtung 40 verwendbar ist. Beispielsweise ist bei diesem Winkel die Prüfvorrichtung auch für ein Endoskop verwendbar, dessen Blickrichtung einen Winkel von 90 Grad zu seiner Längsachse bildet, und dessen Sichtfeld 60 Grad breit ist. Durch noch größere Winkel zwischen der Normale der Ebene, in der der Rand der Referenzoberfläche 72 liegt, und der Längsachse 58, 68 der Positionierungseinrichtung 50, 60 kann das Spektrum der möglichen Blickrichtungen der zu prüfenden Endoskope weiter vergrößert werden. Gleichzeitig ist die halbkugelförmige Referenzoberfläche 72 leicht herstellbar, beispielsweise durch Gießen oder mittels spanabhebender Verfahren, ohne dass Hinterschneidungen geschaffen werden müssten.

[0063] Wichtig für die genannten Vorteile der gekippten Anordnung der Referenzoberfläche 72 ist vor allem, dass die Gerade durch gegenüberliegende Punkte bzw. Orte 77, 78 am Rand der Referenzoberfläche 72 gegenüber der Längsachse 58, 68 der Positionierungseinrichtung 50, 60 gekippt ist. Die Gestalt des Rands der Referenzoberfläche 72 zwischen diesen beiden Punkten 77, 78 kann von einem ebenen Kreisring abweichen, ohne die genannten Vorteile zu schmälern. In Verallgemeinerung dieser Überlegung kann die Referenzoberfläche 72

statt der Gestalt eines Ausschnitts einer Kugeloberfläche die Gestalt eines Ausschnitts einer Kreiszyli-
 nderoberfläche aufweisen. In diesem Fall liegt die Zylinderachse der
 Kreiszyli-
 nderoberfläche insbesondere senkrecht zu den Zei-
 chenebenen der Figuren 4 und 5. Die Gerade zwischen
 den Punkten 77, 78 stellt dann nicht mehr den Rand der
 Referenzoberfläche 72, sondern eine Verbindungsgera-
 de der Punkte 77, 78 dar, die zur Längsachse 58, 68 der
 Positionierungseinrichtung 50, 60 einen Winkel von bei-
 spielsweise 60 Grad bildet.

[0064] Nachfolgend werden anhand der Figuren 7 bis
 10 Verfahren zum Prüfen eines optischen Untersu-
 chungssystems beschrieben, die mittels der oben dar-
 gestellten Prüfvorrichtung 40 ausgeführt werden können.
 Zunächst werden anhand der Figuren 7 und 8 Spektren
 und anhand der Figuren 9 und 10 Weißabgleich-Para-
 meter dargestellt, auf Grundlage derer eine Funktions-
 fähigkeit oder eine andere Eigenschaft des optischen Un-
 tersuchungssystems bestimmt werden kann.

[0065] Figur 7 zeigt eine schematische Darstellung
 von Fluoreszenz-Anregungsspektren sowie Transmissi-
 onsspektren von Beleuchtungs- und Beobachtungsfil-
 tern, die für verschiedene Arten der Fluoreszenz-Diagno-
 stik verwendet werden. Der Abszisse ist die Wellenlänge
 λ zugeordnet. Gezeigt sind neben dem Fluoreszenz-An-
 regungsspektrum 81L, dem Transmissionsspektrum 83L
 des Beleuchtungsfilters und dem Transmissionsspek-
 trum 84L des Beobachtungsfilters für PDD auch das
 Fluoreszenz-Anregungsspektrum 81F, das Transmissi-
 onsspektrum 83F des Beleuchtungsfilters und das
 Transmissionsspektrum 84F des Beobachtungsfilters
 zur Beobachtung von Autofluoreszenz (AF) von Gewe-
 be.

[0066] In Figur 7 sind ferner die spektralen Empfind-
 lichkeiten Sb, Sg, Sr der blauen, grünen und roten Farb-
 rezeptoren des menschlichen Auges dargestellt. Da Ka-
 meras möglichst weitgehend an das Farbempfinden des
 menschlichen Auges angepasst werden, weisen sie in
 der Regel ähnliche spektrale Empfindlichkeiten auf. Im
 Vergleich der Transmissionsspektren 83L, 83F, 84L, 84F
 der Beleuchtungs- und Beobachtungsfiler für PDD und
 AF mit den spektralen Empfindlichkeiten der Farbrezep-
 toren des menschlichen Auges wird deutlich, dass die
 geringen Unterschiede zwischen den Transmissions-
 spektren der Beleuchtungs- und Beobachtungsfiler für
 PDD und AF für das menschliche Auge nur unter guten
 Bedingungen im unmittelbaren Vergleich - der selten
 möglich ist - erkennbar sind.

[0067] Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung
 verschiedener Produkte jeweils eines Transmissions-
 spektrens eines Beleuchtungsfilters und eines Trans-
 missionsspektrens eines Beobachtungsfilters. Die Kur-
 ven sind vertikal geringfügig gegeneinander verschoben,
 damit sie leichter unterschieden werden können. Tat-
 sächlich sind alle Produkte bei Wellenlängen um 400 nm
 und bei Wellenlängen um 500 nm näherungsweise 0.

[0068] Das Produkt 85 aus dem Transmissionsspek-
 trum 83L des PDD-Beleuchtungsfilters und dem Trans-

missionsspektrum 84F des AF-Beobachtungsfilters ist
 für alle Wellenlängen sehr klein bzw. näherungsweise 0.
 Das AF-Beobachtungsfiler ist somit für remittiertes
 PDD-Anregungslicht nicht transparent.

[0069] Das Produkt 86 aus dem Transmissionsspek-
 trum 83F des Beleuchtungsfilters für AF-Diagnostik und
 dem Transmissionsspektrum 84L des Beobachtungsfil-
 ters für PDD ist für Wellenlängen im Bereich von ca. 430
 nm bis ca. 460 nm deutlich größer als 0. Das PDD-Be-
 obachtungsfiler ist für remittiertes AF-Anregungslicht
 somit in einem deutlich sichtbaren Maß transparent.

[0070] Das Produkt 87 aus dem Transmissionsspek-
 trum 83L des Beleuchtungsfilters für PDD und dem
 Transmissionsspektrum 84L des Beobachtungsfilters für
 PDD ist in einem kleinen Wellenlängenbereich zwischen
 ca. 430 nm und ca. 440 nm nicht 0. Das PDD-Beobach-
 tungsfiler ist für remittiertes PDD-Anregungslicht gering-
 fügig transparent.

[0071] Das Produkt 88 aus dem Transmissionsspek-
 trum 83F des Beleuchtungsfilters für AF und dem Trans-
 missionsspektrum 84F des Beobachtungsfilters für AF
 ist in einem kleinen Wellenlängenbereich in der Gegend
 von 460 nm nicht 0. Das AF-Beobachtungsfiler ist für
 remittiertes AF-Anregungslicht geringfügig transparent.

[0072] Bei Betrachtung einer weißen, nicht fluoreszieren-
 den Referenzoberfläche mit einem optischen Unter-
 suchungssystem kann somit unter günstigen Umständen
 unterscheidbar sein, ob ein PDD-Beleuchtungsfiler mit
 einem AF-Beobachtungsfiler oder ein AF-Beleuch-
 tungsfiler mit einem PDD-Beobachtungsfiler kombiniert
 ist. Im ersten Fall wird ein extrem dunkles Bild beobach-
 tet, im zweiten Fall ein im Vergleich zu korrekten Kom-
 binationen von Beleuchtungsfiler und Beobachtungsfil-
 ter zu helles Bild. Kaum unterscheidbar hingegen ist, ob
 ein Beleuchtungsfiler für PDD mit einem Beobachtungsfil-
 ter für PDD oder ein Beleuchtungsfiler für AF mit einem
 Beobachtungsfiler für AF kombiniert ist. In beiden Fällen
 ist das Bild näherungsweise gleich hell, der Unterschied
 in der Wellenlänge ist für das menschliche Auge allenfalls
 unter sehr guten Bedingungen im unmittelbaren Ver-
 gleich unterscheidbar.

[0073] Figur 9 zeigt in einem schematischen Dia-
 gramm typische Weißabgleich-Parameter nach einem
 Weißabgleich an einer weißen, nicht fluoreszierenden
 Referenzoberfläche bei verschiedenen Kombinationen
 von Beleuchtungsfiltern und Beobachtungsfiltern. Die
 Referenzoberfläche ist in diesem Beispiel eine Oberflä-
 che eines Referenzkörpers aus weißem PTFE. Der Ab-
 sisse ist der Weißabgleich-Parameter WBGr, der Ordi-
 nate der Weißabgleich-Parameter WBGb zugeordnet,
 wobei der dritte Weißabgleich-Parameter WBGg per
 Konvention den Wert $WBGg = 128 = 0x080$ aufweist. Bei
 den Messpunkten ist die Filterkombination jeweils ange-
 geben, wobei die Angabe vor dem Pluszeichen das Be-
 leuchtungsfiler und die Angabe nach dem Pluszeichen
 das Beobachtungsfiler angibt. Dabei bedeutet "STD"
 kein Filter (Weißlicht), "PDD" ein Filter für PDD und "AF"
 ein Filter für AF. Zulässige Filterkombinationen sind

STD+STD, PDD+PDD und AF+AF.

[0074] Es ist erkennbar, dass verschiedene Filterkombinationen verschiedene Weißabgleich-Parameter zur Folge haben, die eindeutig zugeordnet und unterschieden werden können. Nach Durchführung eines Weißabgleichs mit einer geeigneten Referenzoberfläche kann somit aus dem Weißabgleich-Parameter auf die vorliegende Filterkombination geschlossen werden.

[0075] Da die Weißabgleich-Parameter von Kamertyp zu Kamertyp und in manchen Fällen sogar von Kamera zu Kamera variieren, können die bei einem Weißabgleich gewonnenen Weißabgleich-Parameter beispielsweise durch in der Kamera abgelegte Korrekturparameter korrigiert werden. Die in der Kamera abgelegten Korrekturparameter sind beispielsweise ohne Beleuchtungs- und Beobachtungsfiler an einer weißen Fläche gewonnene Weißabgleich-Parameter. Diese Korrekturparameter können statt in der Kamera 31 auch in der Kamerasteuerung 35 abgelegt sein. Weitere Korrekturen können für die Bauform oder den Typ des Endoskops erfolgen, da starre und flexible Endoskope, Endoskope mit unterschiedlichen Durchmessern oder für unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Transmissionsspektren im Beleuchtungs-Strahlengang und im Beobachtungs-Strahlengang aufweisen.

[0076] Bei Verwendung einer nicht-weißen Referenzoberfläche für einen Weißabgleich kann die Genauigkeit bzw. Zuverlässigkeit der Unterscheidung verschiedener Filterkombinationen anhand der Weißabgleichparameter weiter verbessert werden. Dies gilt insbesondere, wenn Kanten bzw. Flanken in Absorptions- oder Fluoreszenzanregungsspektren in der Nähe der Filterkanten der zu unterscheidenden Beleuchtungs- und Beobachtungsfiler liegen.

[0077] Figur 10 zeigt in einem schematischen Diagramm Weißabgleich-Parameter für verschiedene Filterkombinationen bei einem Weißabgleich an einer Referenzoberfläche aus einer deckenden Schicht der von Marabu vertriebenen Farbe Maragloss GO 320 Fluoresco Gelb. Abszisse und Ordinate sowie Kennzeichnung der Messwerte entsprechen denen aus Figur 9. Ein Vergleich der Figuren 9 und 10 zeigt, dass eine besonders sichere Identifikation der vorliegenden Filterkombination möglich ist, wenn sowohl die Weißabgleich-Parameter aus einem Weißabgleich an einer Teflonoberfläche als auch die Weißabgleich-Parameter aus einem Weißabgleich an einer deckenden Schicht von Marabu Maragloss GO Fluoresco 320 gelb kombiniert werden. Weitere Verbesserungen sind beispielsweise durch eine logische oder algebraische Verknüpfung der Weißabgleich-Parameter möglich.

[0078] Figur 11 zeigt ein schematisches Flussdiagramm eines Verfahrens zum Prüfen eines optischen Untersuchungssystems mit einer bildgebenden Einrichtung, einer Kamera und einer Lichtquelle zur optischen Untersuchung eines Objekts. Obwohl das Verfahren auch an optischen Untersuchungssystemen und mit Prüfvorrichtungen anwendbar ist, die sich von den oben

dargestellten unterscheiden, werden nachfolgend zur Vereinfachung des Verständnisses beispielhaft Bezugszeichen aus den Figuren 1 bis 6 verwendet. Bei dem Verfahren werden Merkmale von Spektren, wie sie in den Figuren 7 und 8 dargestellt sind, und von Weißabgleichparametern, wie sie in den Figuren 9 und 10 dargestellt sind, verwendet, um die Funktionsfähigkeit des optischen Untersuchungssystems zu prüfen oder eine andere Eigenschaft des optischen Untersuchungssystems zu bestimmen, beispielsweise darin enthaltene Beleuchtungs- und Beobachtungsfiler.

[0079] Bei einem optionalen ersten Schritt wird eine vorgesehene Anwendung des optischen Untersuchungssystems erfasst, beispielsweise an einer Benutzerschnittstelle nach einer entsprechenden Aufforderung. Bei einem optionalen zweiten Schritt wird eine der vorgesehenen Anwendung zugeordnete Bedingung an einen Betriebszustand der Kamera 31 des optischen Untersuchungssystems ermittelt, beispielsweise durch Auslesen einer Look-up-Tabelle. Eine oder mehrere Bedingungen für den Betriebszustand der Kamera 31 können alternativ unveränderlich vorgegeben sein.

[0080] Bei einem dritten Schritt 103 wird ein distales Ende einer bildgebenden Einrichtung, insbesondere eines Endoskops 10, durch eine Öffnung 43 in einen Hohlraum 42 in einem lichtdichten Gehäuse 41 eingeführt. Bei einem optionalen vierten Schritt 104, der nach dem dritten Schritt 103 oder gleichzeitig mit diesem ausgeführt werden kann, wird das distale Ende der bildgebenden Einrichtung in einer vorbestimmten Position und Richtung relativ zu einer in dem Hohlraum 42 angeordneten Referenzoberfläche 72 angeordnet. Dies erfolgt unterstützt durch eine Positionierungseinrichtung, die die bildgebende Einrichtung 10, insbesondere deren distales Ende 12 führt und/oder form- oder kraftschlüssig hält.

[0081] Bei einem fünften Schritt 105 wird die Referenzoberfläche 72 mit Beleuchtungslicht mit einem Beleuchtungsspektrum beleuchtet. Wenn die bildgebende Einrichtung ein Endoskop 10 ist, erfolgt die Beleuchtung insbesondere mittels des Endoskops bzw. über einen Beleuchtungs-Strahlengang im Endoskop 10. Bei einem optionalen sechsten Schritt 106 wird ein Weißabgleich, wie er oben beschrieben ist, durchgeführt während die Referenzoberfläche beleuchtet wird. Dabei werden beispielsweise Weißabgleich-Parameter WBGr, WBGb eingestellt.

[0082] Bei einem siebten Schritt 107 wird während des Beleuchtens der Referenzoberfläche 72 mittels der bildgebenden Einrichtung 10 und der Kamera 31 ein Bild erfasst. Bei einem achten Schritt 108 wird der während des siebten Schritts 107 vorliegende Betriebszustand der Kamera 31 erfasst, insbesondere aus der Kamera 31 oder der Kamerasteuerung 35 ausgelesen. Alternativ wird beispielsweise ein Rauschpegel oder ein Signal-Rausch-Abstand im erfassten Bild bestimmt, aus dem auf den Betriebszustand der Kamera 31 geschlossen wird. Der Betriebszustand der Kamera umfasst beispielsweise Weißabgleich-Parameter WBGr, WBGb, eine für

alle Farbkanäle geltende Belichtungszeit, eine für alle Farbkanäle geltende Verstärkung oder für einzelne Farbkanäle geltende Belichtungszeiten und Verstärkungen.

[0083] Bei einem optionalen neunten Schritt 109 wird aus dem erfassten Betriebszustand der Kamera ein Belichtungsparameter ermittelt, insbesondere berechnet. Beispielsweise wird aus einer Belichtungszeit T und einer Verstärkung G ein Belichtungsparameter E nach der Formel $E = a \cdot T^b \cdot G^c$ berechnet. Bei einem ebenfalls optionalen zehnten Schritt 110 wird der ermittelte Belichtungsparameter mit einem oder mehreren einer vorgesehenen Anwendung zugeordneten oder pauschal geltenden Schwellenwerten verglichen. Alternativ oder zusätzlich wird der Betriebszustand der Kamera bzw. die ihn charakterisierenden Parameter mit anderen der vorbestimmten Anwendung des optischen Untersuchungssystems zugeordneten und pauschal geltenden Bedingungen verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs zeigt die Funktionsfähigkeit oder eine andere Eigenschaft des optischen Untersuchungssystems an.

[0084] Wenn beim achten Schritt 108 Weißabgleich-Parameter erfasst werden, kann anhand eines Vergleichs der Weißabgleich-Parameter mit Schwellenwerten bestimmt werden, welches Beleuchtungsfilter bzw. welches Beleuchtungs-Spektrum und welches Transmissionsspektrum im Beobachtungs-Strahlengang beim Erfassen des Bilds vorlag. Dazu liegen die Schwellenwerte insbesondere zwischen den beispielsweise in den Figuren 9 und 10 erkennbaren Bereichen, die den verschiedenen Filterkombinationen zugeordnet sind.

[0085] Wenn beim achten Schritt 108 Belichtungszeiten, Verstärkungen oder andere Parameter erfasst werden, die einzelnen Farbkanälen zugeordnet sind, sind diese Parameter des Betriebszustands ähnlich wie Weißabgleich-Parameter von der vorliegenden Filterkombination abhängig. Aus den den einzelnen Farbkanälen zugeordneten Parametern des Betriebszustands kann deshalb ebenfalls auf die vorliegende Filterkombination geschlossen werden. Dazu werden die den einzelnen Farbkanälen zugeordneten Parameter des Betriebszustands oder aus diesen berechnete Belichtungsparameter mit entsprechenden Schwellenwerten verglichen.

[0086] Bei einem optionalen elften Schritt 111 wird eine Meldung ausgegeben, die eine Aussage über die Funktionsfähigkeit des optischen Untersuchungssystems, eine Handlungsempfehlung und/oder eine Handlungsanweisung umfassen kann. Bei einem zwölften Schritt 112, der auch zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt in dem Verfahren ausgeführt werden kann, werden Patientendaten erfasst, beispielsweise mittels einer Benutzerschnittstelle. Bei einem optionalen dreizehnten Schritt 113 werden die Patientendaten, das Ergebnis des Prüfverfahrens hinsichtlich der Funktionsfähigkeit oder hinsichtlich der anderen Eigenschaft des optischen Untersuchungssystems und optional das Ergebnis einer nachfolgenden oder vorangehenden Untersuchung eines Patienten mittels des optischen Untersuchungssy-

stems in einer Datenbank abgelegt.

[0087] Insbesondere bei Verwendung einer Kamera 31 können ferner Modellbezeichnungen, Seriennummern, Software- oder Firmware-Versionen und andere Daten von Komponenten des optischen Untersuchungssystems über eine Kommunikationsleitung 39 abgefragt und zur Dokumentation bzw. Protokollierung in der Datenbank abgelegt werden. Ferner kann in der Datenbank oder separat auf einem anderen Datenträger die Untersuchung des Patienten dokumentiert bzw. protokolliert werden. Dabei werden beispielsweise Bilder bzw. ein Videodatenstrom der Kamera 31 in der Datenbank (beispielsweise in einem MPEG-Format) oder auf einem Videoband abgelegt.

[0088] Bezugszeichen

- 10 Endoskop
- 11 proximales Ende des Endoskops 10
- 12 distales Ende des Endoskops 10
- 13 Beobachtungsfilter des Endoskops 10
- 14 Okular am proximalen Ende des Endoskops 10
- 15 Kupplung am Endoskop 10 für Lichtleitkabel 19
- 17 Schaft des Endoskops 10
- 19 Lichtleitkabel zu Kopplung des Endoskops 10 mit der Lichtquellenvorrichtung 20
- 20 Lichtquellenvorrichtung
- 22 Lichtquelle der Lichtquellenvorrichtung 20
- 23 erste Sammellinse
- 24 Beleuchtungsfilter der Lichtquellenvorrichtung 20
- 25 zweite Sammellinse
- 26 Kupplung an der Lichtquellenvorrichtung 20 für Lichtleitkabel 19
- 31 Kamera
- 33 Signalkabel
- 35 Kamerasteuerung
- 37 Bildschirm
- 39 Kommunikationsleitung
- 40 Prüfvorrichtung

41	lichtdichtes Gehäuse der Prüfvorrichtung 40		76	Referenzbereich an der Referenzfläche 72
42	Hohlraum im Gehäuse 41		77	erster Ort am Rand der Referenzoberfläche 72
43	Öffnung im Gehäuse 41	5	78	zweiter Ort am Rand der Referenzoberfläche 72
44	Standfuß des Gehäuses 41		81	Fluoreszenz-Anregungsspektrum
45	Stift		82	Fluoreszenz-Abregungsspektrum
46	Kugel-Rasteinrichtung	10	83	Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters
48	Nut im Gehäuse 41		83L	Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters für PDD
49	Schraubverschluss	15	83F	Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters für AF
50	erste Positionierungseinrichtung			
51	vom Hohlraum 42 abgewandtes Ende der ersten Positionierungseinrichtung 50	20	84	Transmissionsspektrum des Beobachtungsfilters
52	dem Hohlraum 42 zugewandtes Ende der ersten Positionierungseinrichtung 50		84L	Transmissionsspektrum des Beobachtungsfilters für PDD
53	Nut in der ersten Positionierungseinrichtung 50	25	84F	Transmissionsspektrum des Beobachtungsfilters für AF
56	Anschlag für Endoskop 10		85	Produkt aus 83L und 84F
57	Kugel-Rasteinrichtung am vom Hohlraum 42 abgewandten Ende 51 der ersten Positionierungseinrichtung	30	86	Produkt aus 83F und 84L
58	Längsachse der ersten Positionierungseinrichtung 50		87	Produkt aus 83L und 84L
		35	88	Produkt aus 83F und 84F
60	zweite Positionierungseinrichtung		101	erster Schritt (Erfassen einer vorgesehenen Anwendung)
61	vom Hohlraum 42 abgewandtes Ende der zweiten Positionierungseinrichtung 60		102	zweiter Schritt (Ermitteln eines Schwellenwerts)
		40		
62	dem Hohlraum 42 zugewandtes Ende der zweiten Positionierungseinrichtung 60		103	dritter Schritt (Einführen des distalen Endes des Endoskops)
63	Nut in der zweiten Positionierungseinrichtung 60		104	vierter Schritt (Anordnen des distalen Endes des Endoskops)
		45		
66	Anschlag für distales Ende 12 des Endoskops 10		105	fünfter Schritt (Beleuchten einer Referenzoberfläche)
68	Längsachse der zweiten Positionierungseinrichtung 60			
		50	106	sechster Schritt (Durchführen eines Weißabgleichs)
70	Referenzkörper der Prüfvorrichtung 40			
72	Referenzoberfläche am Referenzkörper 70		107	siebter Schritt (Erfassen eines Bilds mittels Endoskop und Kamera)
74	Stift am Referenzkörper 70	55		
75	Indikatorbereich an der Referenzfläche 72		108	achter Schritt (Erfassen eines Betriebszustands der Kamera)

- 109 neunter Schritt (Berechnen eines Belichtungsparameters) Positionierungseinrichtung (50; 60) um ihre Längsachse (58; 68).
- 110 zehnter Schritt (Vergleichen mit einem Schwellenwert) 5 5. Prüfvorrichtung (40) nach Anspruch 3 oder 4, ferner mit:
- 111 elfter Schritt (Ausgeben einer Handlungsempfehlung) einer Rasteinrichtung (46), die dazu ausgebildet ist, die Positionierungseinrichtung (50; 60) an der Öffnung (43) lösbar zu befestigen.
- 112 zwölfter Schritt (Erfassen von Patientendaten) 10 6. Prüfvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der die Positionierungseinrichtung (50) an ihrem vom Hohlraum (42) abgewandten Ende (51) eine **Halteeinrichtung** (57) zum Halten des proximalen Endes (11) einer in die Prüfvorrichtung (40) eingesetzten bildgebenden Einrichtung (10).
- 113 dreizehnter Schritt (Ablegen in Datenbank) 15

Patentansprüche

1. **Prüfvorrichtung** (40) für ein optisches Untersuchungssystem mit einer bildgebenden Einrichtung (10) und einer Lichtquelle (22) zur optischen Untersuchung eines Objekts in remittiertem Licht und/oder Fluoreszenzlicht, mit:
- einem **Gehäuse** (41) mit einem Hohlraum (42) und einer Öffnung (43) zum Einführen eines distalen Endes (12) der bildgebenden Einrichtung (10) in den Hohlraum (43);
- einer **Referenzoberfläche** (72) mit vorbestimmten optischen Eigenschaften in dem Hohlraum (42), zumindest entweder zur Remission von auf die Referenzoberfläche (72) gerichtetem Beleuchtungslicht oder zur Emission von Fluoreszenzlicht;
- einer **Positionierungseinrichtung** (50; 60) zum Halten der bildgebenden Einrichtung (10) bei einer vorbestimmten Position des distalen Endes (12) der bildgebenden Einrichtung (10) relativ zur Referenzoberfläche (72).
2. Prüfvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der die Positionierungseinrichtung (50; 60) ferner dazu ausgebildet ist, eine **Rotation** einer in die Prüfvorrichtung (40) eingesetzten bildgebenden Einrichtung (10) um ihre Längsachse zu unterbinden.
3. Prüfvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der die Prüfvorrichtung (40) so ausgebildet ist, dass die Positionierungseinrichtung (50; 60) ohne Verwendung von Werkzeug von dem Gehäuse (41) getrennt und wieder mit ihm verbunden werden kann.
4. Prüfvorrichtung (40) nach dem vorangehenden Anspruch, ferner mit:
- Einrichtungen (45, 53; 63) am Gehäuse (41) und an der Positionierungseinrichtung (50; 60) zum formschlüssigen Unterbinden einer Rotation der
7. Prüfvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der die Positionierungseinrichtung (60) am dem Hohlraum (42) zugewandten Ende (62) einen mechanischen **Anschlag** (66) aufweist, der so ausgebildet ist, dass das distale Ende (12) einer in die Prüfvorrichtung (40) eingesetzten bildgebenden Einrichtung (10) an einer vorbestimmten Position liegt, wenn die bildgebende Einrichtung (10) an dem Anschlag (66) anliegt.
8. Prüfvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der die Referenzoberfläche (72) einen Ausschnitt aus einer **Kugeloberfläche** bildet, wobei die für das distale Ende (12) der bildgebenden Einrichtung (10) vorgesehene Position am Mittelpunkt der Kugeloberfläche liegt; oder einen Ausschnitt aus einer **Kreiszyylinderfläche** bildet, wobei die für das distale Ende (12) der bildgebenden Einrichtung (10) vorgesehene Position an der Symmetrieachse der Kreiszyylinderfläche liegt.
9. Prüfvorrichtung (40) nach dem vorangehenden Anspruch, bei der die Referenzoberfläche (72) einen Ausschnitt aus einer Kugeloberfläche bildet, wobei zwei gegenüberliegende Orte (77, 78) am Rand der Referenzoberfläche (72) auf einer Geraden (79) liegen, die einen **Winkel** im Bereich von 40 Grad bis 80 Grad zur Längsachse einer von der Positionierungseinrichtung (50; 60) gehaltenen bildgebenden Einrichtung (10) bildet; oder die Referenzoberfläche (72) einen Ausschnitt aus einer Kugeloberfläche bildet, wobei der Rand der Referenzoberfläche (72) in einer Ebene (78) liegt, deren Normale einen **Winkel** im Bereich von 10 Grad bis 50 Grad zur Längsachse einer von der Positionierungseinrichtung (50; 60) gehaltenen bildgebenden Einrichtung (10) bildet; oder die Referenzoberfläche (72) einen Ausschnitt aus einer Kreiszyylinderfläche bildet, wobei eine Gerade (79) durch zwei gegenüberliegende Ränder (77, 78)

der Referenzoberfläche (72) einen Winkel zwischen 40 Grad und 80 Grad zur Längsachse einer von der Positionierungseinrichtung (50; 60) gehaltenen bildgebenden Einrichtung (10) bildet.

5

10. Prüfvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Prüfvorrichtung **zerlegbar** und **sterilisierbar** ist.
11. Prüfvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der die Referenzoberfläche (72) **weiß** ist oder einen weißen Bereich umfasst.
12. Prüfvorrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei welcher die Referenzoberfläche (72) durch **Polytetrafluorethylen** oder **Silikon** gebildet wird.
13. **Verfahren zum Prüfen** eines optischen Untersuchungssystems mit einer bildgebenden Einrichtung (10) und einer Lichtquelle (22) zur optischen Untersuchung eines Objekts in remittiertem Licht und Fluoreszenzlicht, mit folgenden Schritten:
- Einführen (103) des distalen Endes (12) der bildgebenden Einrichtung (10) durch eine Öffnung (43) in einen Hohlraum (42) in einem **Gehäuse** (41);
- Anordnen (104) des distalen Endes (12) der bildgebenden Einrichtung (10) an einer **vorbestimmten Position** relativ zu einer Referenzoberfläche (72) mit vorbestimmten optischen Eigenschaften in dem Hohlraum (42);
- Beleuchten** (105) der Referenzoberfläche (72) mit Beleuchtungslicht mit einem vorbestimmten Spektrum mittels der bildgebenden Einrichtung (10);
- Erfassen** (107) von durch die Referenzoberfläche (72) remittiertem Licht mittels der bildgebenden Einrichtung (10);
- Bestimmen der **Funktionsfähigkeit** oder einer anderen Eigenschaft des optischen Untersuchungssystems anhand des erfassten remittierten Lichts.

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 1

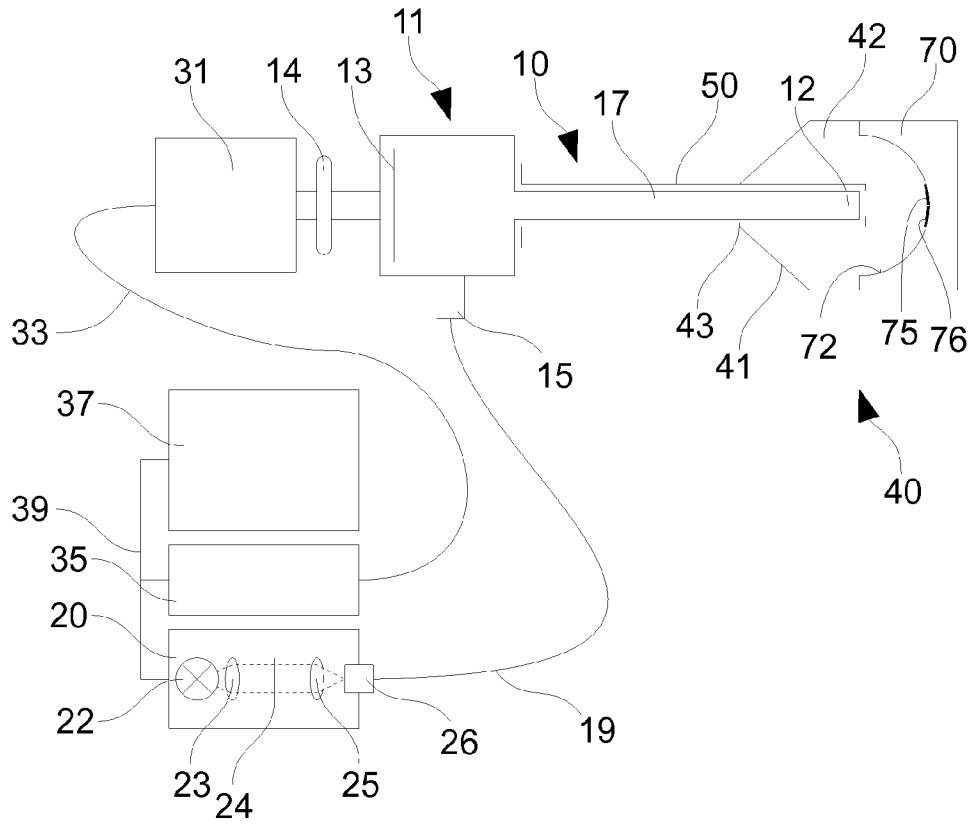


Fig. 2

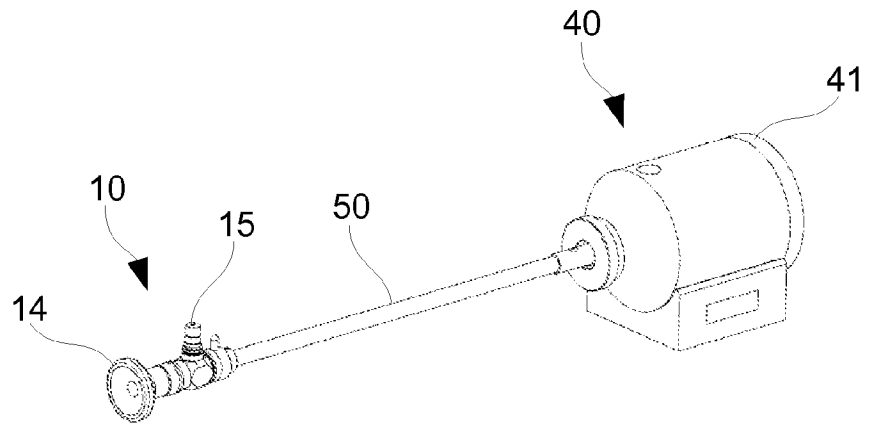


Fig. 3

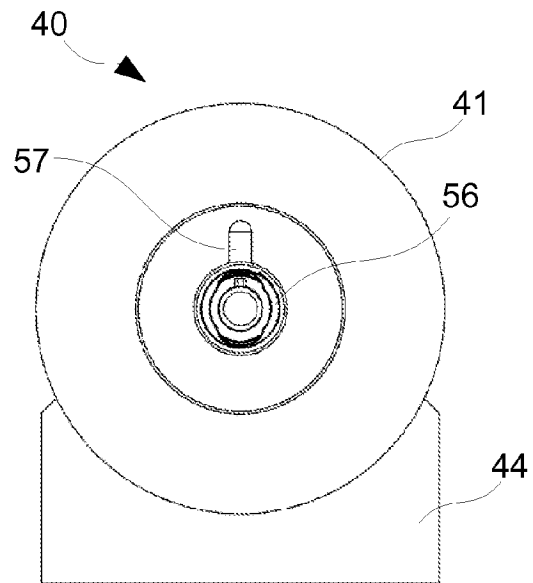


Fig. 4

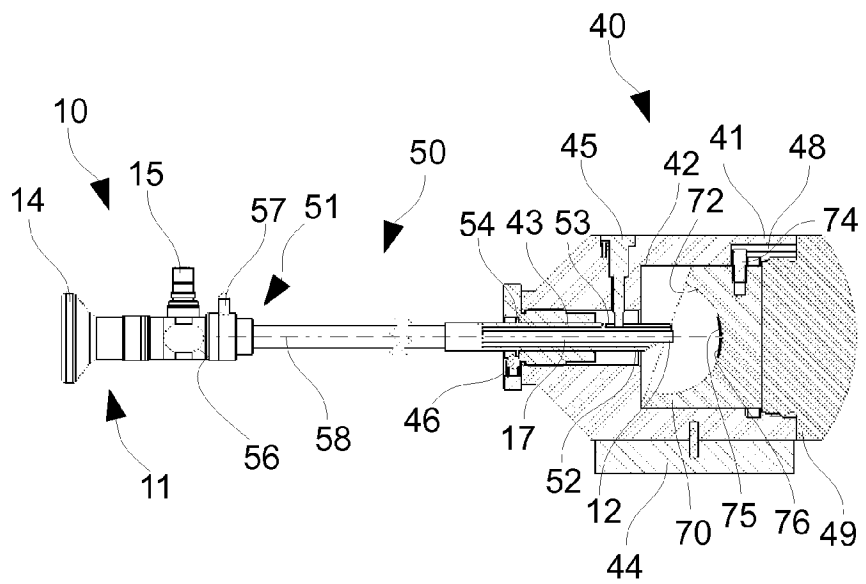


Fig. 5

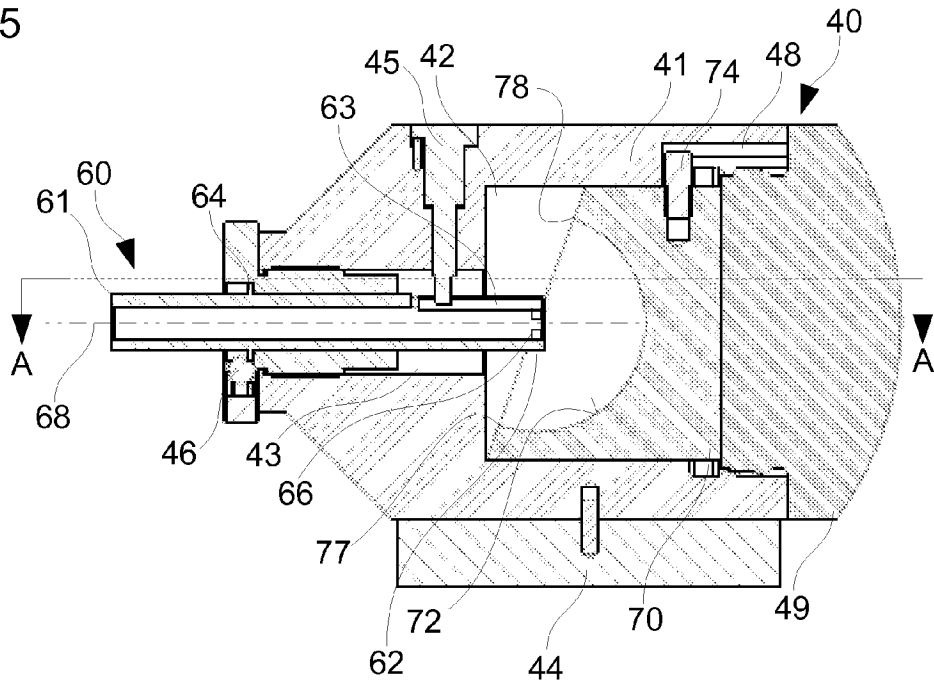


Fig. 6

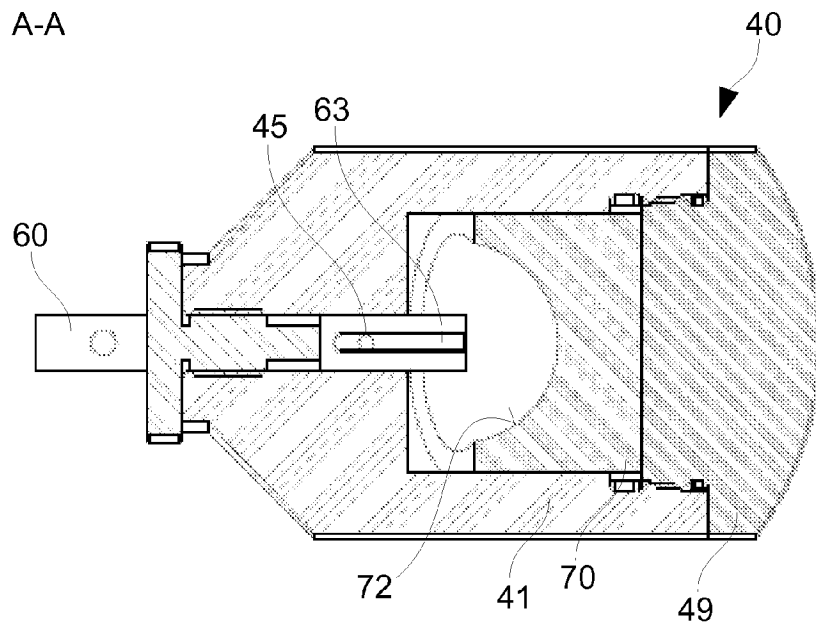


Fig. 7

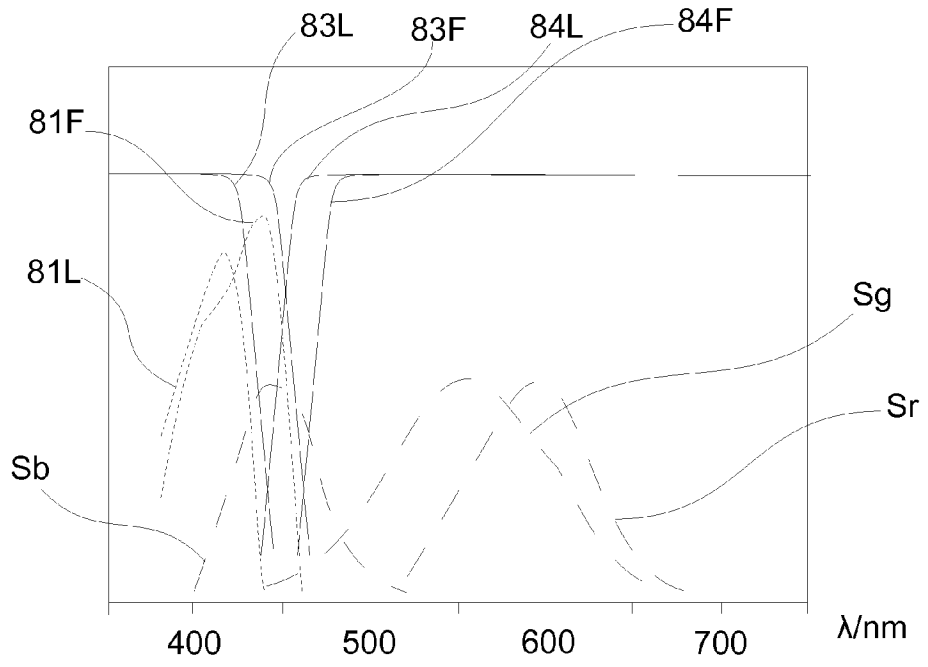


Fig. 8

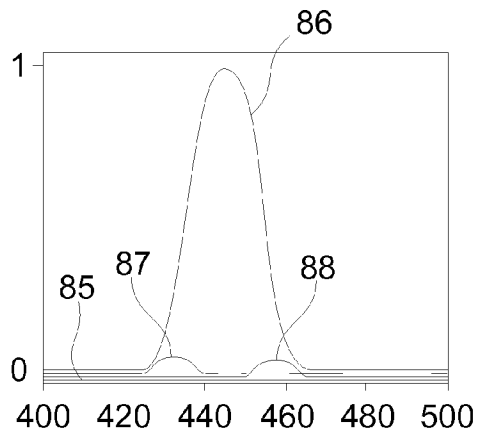


Fig. 9

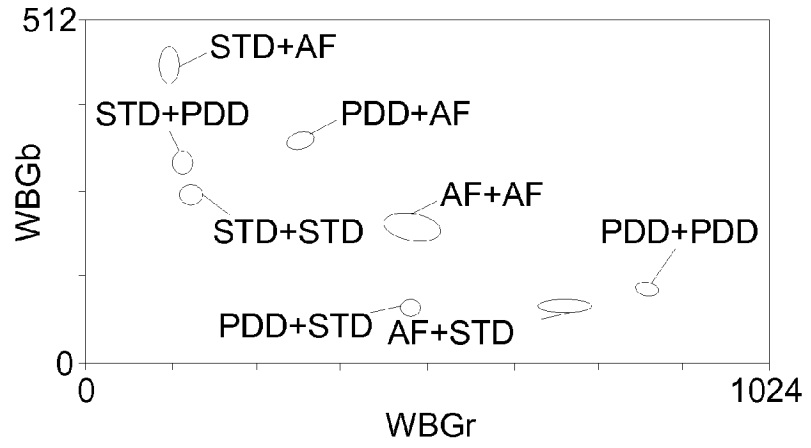


Fig. 10

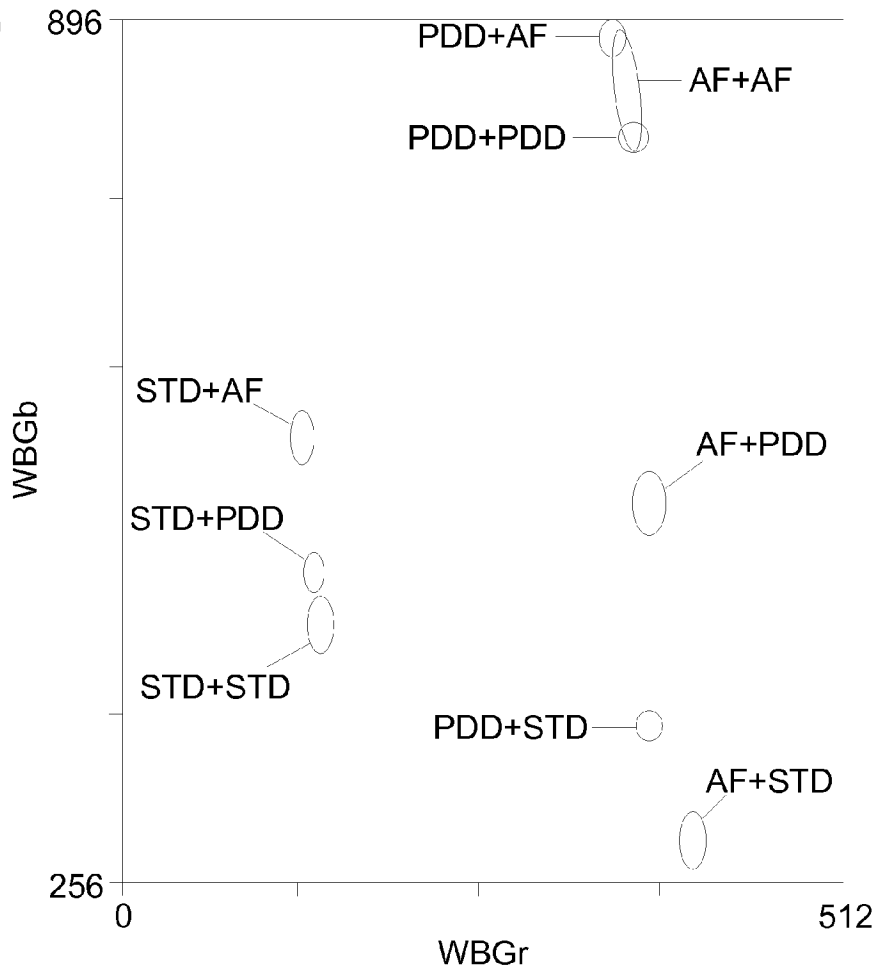
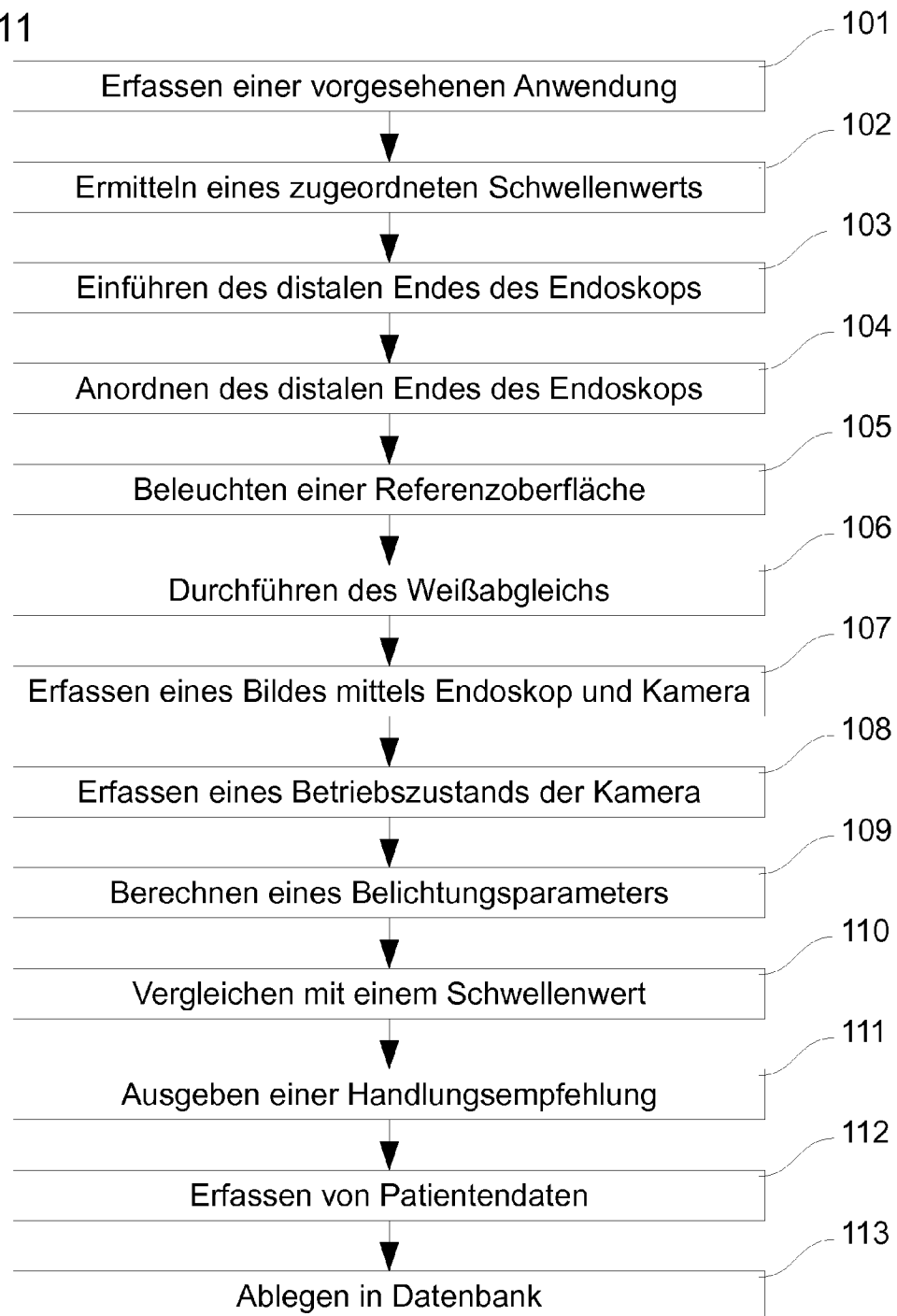


Fig. 11





Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 10 19 4669

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X,D	DE 196 38 809 A1 (STORZ KARL GMBH & CO [DE] STORZ KARL GMBH & CO KG [DE]) 2. April 1998 (1998-04-02)	1-12	INV. A61B1/00 A61B5/00 A61B5/1495 G01N21/64
Y	* Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 44 - Spalte 4, Zeile 21 * * Spalte 5, Zeile 14 - Spalte 6, Zeile 7 * * Spalte 7, Zeile 24 - Zeile 33 * * Spalte 7, Zeile 62 - Zeile 67 * * Spalte 6, Zeile 37 - Zeile 54 * * Abbildung 1 *	13	
X,D	DE 198 55 853 A1 (STORZ KARL GMBH & CO KG [DE]) 15. Juni 2000 (2000-06-15) * Zusammenfassung * * Spalte 5, Zeile 15 - Spalte 6, Zeile 34 * * Abbildung 1 *	1	
Y	US 2003/105195 A1 (HOLCOMB NELSON R [US] ET AL) 5. Juni 2003 (2003-06-05) * Zusammenfassung * * Absatz [0052] - Absatz [0053] * * Ansprüche 42,43 *	13	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) A61B G01N
A	WO 97/11636 A2 (STORZ KARL GMBH & CO [DE]; IRION KLAUS [DE]; BAUMGARTNER REINHOLD [DE]) 3. April 1997 (1997-04-03) * Zusammenfassung * * Seite 28 - Seite 37 * * Abbildung 1 *	1-13	
A	EP 1 728 464 A1 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP [JP]) 6. Dezember 2006 (2006-12-06) * Zusammenfassung * * Absatz [0024] - Absatz [0077] * * Abbildungen 1-4 *	1	
----- -/--			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
1	Recherchenort München	Abschlußdatum der Recherche 22. März 2011	Prüfer Tommaso, Giovanni
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 10 19 4669

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
A	US 2003/078477 A1 (KANG UK [KR] ET AL) 24. April 2003 (2003-04-24) * das ganze Dokument * -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 22. März 2011	Prüfer Tommaseo, Giovanni
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

1
EPO FORM 1503 03.82 (PC/MC03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 10 19 4669

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

22-03-2011

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19638809	A1	02-04-1998	WO 9811945 A1	26-03-1998
			DE 59704611 D1	18-10-2001
			EP 0930916 A1	28-07-1999
			US 6361490 B1	26-03-2002

DE 19855853	A1	15-06-2000	WO 0034762 A1	15-06-2000
			US 2002077677 A1	20-06-2002

US 2003105195	A1	05-06-2003	US 2005137280 A1	23-06-2005

WO 9711636	A2	03-04-1997	DE 29620732 U1	24-04-1997
			EP 0861044 A1	02-09-1998
			JP 3621704 B2	16-02-2005
			JP 11511369 T	05-10-1999
			US 6212425 B1	03-04-2001

EP 1728464	A1	06-12-2006	KEINE	

US 2003078477	A1	24-04-2003	CN 1415267 A	07-05-2003
			JP 2003204924 A	22-07-2003
			KR 20030033177 A	01-05-2003

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 19638809 A1 [0007]
- DE 19855853 A1 [0008]
- DE 102009043696 [0009]

专利名称(译)	光学检测系统的测试装置		
公开(公告)号	EP2335556A1	公开(公告)日	2011-06-22
申请号	EP2010194669	申请日	2010-12-13
[标]申请(专利权)人(译)	KARL STORZ		
申请(专利权)人(译)	KARL STORZ GMBH & CO.KG		
当前申请(专利权)人(译)	KARL STORZ GMBH & CO.KG		
[标]发明人	BECK GERD EHRHARDT ANE GLOGGLER BERNHARD		
发明人	BECK, GERD EHRHARDT, ANDRÉ GLÖGGLER, BERNHARD		
IPC分类号	A61B1/00 A61B5/00 A61B5/1495 G01N21/64		
CPC分类号	A61B1/00057 A61B1/043 A61B5/0059 A61B5/1495 A61B2560/0233 G01N21/276		
优先权	102009058660 2009-12-16 DE		
其他公开文献	EP2335556B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

该装置 (40) 具有一个带有中空空间 (42) 的光绝缘壳体 (41) 和一个孔 (43)，用于将成像装置的远端 (12)，即内窥镜 (10) 插入中空空间。具有预定光学特性的参考表面 (72) 形成在中空空间中，用于缓和指向参考表面上的照射光或用于发射荧光。定位装置 (50) 将成像装置保持在成像装置的远端相对于参考表面的预定位置。对于用于测试光学调查系统的方法，还包括独立权利要求。

Fig. 1

